

DEFEKTOSKOPIJA (nerazorna), skup metoda za pronaalaenje skrivenih grešaka u materijalu (nastalih pri proizvodnji osnovnog materijala, pri izradi dijelova ili sklopova, ili kao posljedica projektnih elemenata, uvjeta eksploracije itd.) na takav način da ispitani materijali, dijelovi strojeva i uredaji ostaju nakon pregleda neoštećeni i mogu, ako u njima nisu otkrivene nedopuštene greške, biti stavljeni u normalnu eksploraciju.

U stručnoj literaturi (naročito u njemačkoj i anglosaksonskoj) nerazorna defektoskopija često se ne izdvaja iz šire cjeline metoda *ispitivanja materijala bez razaranja* (zerstörungsfreie Prüfverfahren, nondestructive testing, неразрушающее испытание), u kojoj ona sačinjava dominantan dio. (Osim metoda za otkrivanje grešaka, ispitivanje materijala bez razaranja obuhvaća npr. određivanje hraptovosti površine, rendgensku, elektronsku i neutronsku kristalografsku, spektralnu analizu, rendgensku spektroskopiju, mjerjenje deblijine stijenki, prevlaka i premaza, ispitivanje čeličnih užeta.)

Kad se govori naprosto o defektoskopiji, podrazumijeva se nerazorna defektoskopija, jer za metode pronaalaenja grešaka u materijalu uz njegovo razaranje (npr. mehaničkim ispitivanjima, metalografijom itd.) izraz »razorna defektoskopija« nije jako uobičajen.

Nesumnjivo najstariji način ispitivanja materijala bez razaranja predstavlja očni (vizuelna kontrola). Po pronaalaenju drugih metoda defektoskopije ova defektoskopska metoda bila je ponešto izgubila od svog značenja, ali uvođenjem modernih pomagala (introskopa, televizije itd.) ona počinje opet dobivati veći ugled. Tehnička primjena X- i gama-zraka počinje tek mnogo godina posli su otkriveni (W. K. Röntgen 1895, H. Becquerel 1896, E. Rutherford 1897, bračni par Curie 1898). Najveći udjel u uvođenju tih zraka u tehničku praksu imali su A. H. Compton (1879—1927) i E. Fermi (1901—1954).

Prvi radiogrami dobiveni su u Evropi 1923 a godinu dana kasnije H. H. Lester izvodi prvu radiografsku kontrolu posude pod pritiskom za Boston Edison Co. Power Station. Mnogo starije od ovih metoda su ispitivanje pomoću vodenog pritiška i pregleđivanje površina metodom »petrolej-kreda«, koja predstavlja preteču današnjih ispitivanja penetrantskih tekućinama. Magnetska, ultrazvučna i električna ispitivanja uvedena su u defektoskopiju tek nakon drugog svjetskog rata i dozivjela su puni razvoj u posljednja dva decenija. Danas svi proizvođači uredaja i aparata za defektoskopiju intenzivno rade na pronaalaenju metoda za automatsku kontrolu s obilježavanjem neispravnih proizvoda, sortiranjem po kvalitetu itd.

Danas je defektoskopija normalna potreba u skoro svim tipovima proizvodnje i predstavlja obično jednu od faza u tehnološkom procesu izrade. Laboratoriji za defektoskopsku kontrolu gotovo su redovito koncentrirani i predstavljaju centralna mesta za ispitivanje kvaliteta izrade. U nekim velikoserijskim i masovnim proizvodnjama nalaze se i odijeljene laboratorije na određenim kontrolnim tačkama proizvodnje. U nekim zapadnim zemljama postoje i velike organizacije koje se bave isključivo defektoskopijom za račun industrije (npr. Röntgen Technische Dienst — Nizozemska), fundamentalnim ispitivanjima i uvođenjima novih metoda defektoskopije (npr. Institut Dr. Foerster — S. R. Njemačka) ili uza sve to i proizvodnjom uredaja za defektoskopiju (npr. Magnaflux Corporation — USA).

Poznate i najčešće upotrebljavane metode defektoskopije daju se grubo podijeliti na: 1. metode prozračavanja, 2. metode proučavanja, 3. magnetske (induktivne) metode, 4. penetrantske metode, 5. metode vizuelnog pregleda. Svaka od navedenih metoda sadrži više varijanti ispitivanja koje su u principu i provođenju dosta različite, ali baziraju na iskorištenju iste fizičke pojave ili istog svojstva materijala.

Za svaki tip greške, zavisno od materijala u kojem se nalazi, oblika, veličine i položaja, postoji varijanta ili metoda defektoskopije koja će osigurati najbolju vidljivost i interpretaciju. Vrlo je mali broj grešaka koje se daju otkriti svim metodama. Osim toga svaka metoda ima određena ograničenja zavisno od složenosti oblika ispitivanog predmeta, stanja površine, deblijine i sl. U tablici 1 prikazana je pogodnost pronaalaenja i određivanja različitih tipova grešaka u nekim najčešćim oblicima proizvoda izrađenim od magnetskih materijala, a u tablici 2 istih proizvoda od nemagnetičkih metala i najviše upotrebljivih nemetalica

Tablica 1
MOGUĆNOST OTKRIVANJA GREŠAKA U MAGNETIČNIM ILI TEŠKIM METALIMA

		Općenito	Limovi i profili	Šipke i cijevi	Odjevci	Otkivci	Zavari	Obrađa	Eksploracija
● odlična mogućnost	○ dobra mogućnost	○ slaba mogućnost							
1 samo za tankе presjeke									
2 može biti odlična mogućnost ako je zračenje paralelno s pukotinama									
3 uz korištenje komparatora za deblijinu									
Opća klasifikacija metoda ispitivanja	Izbor tipa ispitivanja u određenoj metodi	Male površinske pukotine	Veće površinske pukotine	Unutrašnje pukotine	Uzdužne brazde	Cijevni oblici	Lokalna zadržavanja	Uključci	Dvoslojnost
Metode prozračavanja	Radiografija (rendgen)	● ○	● ○	● ○	○ ○	● ○	● ○	● ○	● ○
	Fluoroskopija ²	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	Gamagrafija (radio-izotopi)	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Metode proučavanja	Kontaktna metoda	ravne glave kutne glave impuls-jeka površinski valovi	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Imerziona metoda	ravne glave kutne glave impuls-jeka površinski valovi	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Transmisiona metoda		● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Rezonantna metoda		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
Magnetske metode	Izmjenična struja, mokra metoda	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Izmjenična struja, suha metoda	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Istosmjerna struja, mokra metoda	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Istosmjerna struja, suha metoda	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
Elektromagnetske metode	Metoda vrložnih struja	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Metoda magnetskog polja	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Metoda rasipnog polja	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Metoda strujne provodljivosti	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
Penetrantske metode	Obični penetranti	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
	Fluorescentni penetranti	● ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○

Osnovne su zadaće defektoskopije: osigurati pouzdanost proizvoda i jednolikost kvaliteta; spriječiti nesreće, materijalne i ljudske gubitke; smanjiti proizvodne troškove pravovremenum izlučivanjem neispravnih dijelova i omogućiti uvođenje novih materijala i tehnoloških procesa u cilju postizanja jeftinijeg i si gurnijeg proizvoda.

Iz tablice je, iako su grubo orientacionog karaktera, dobro vidljivo da se za detekciju određenog tipa greške u nekom proizvodu može upotrijebiti samo mali broj metoda defektoskopije. Zbog toga je važno pri određivanju kontrole proizvoda ocijeniti unaprijed nedopustive tipove i oblike grešaka i prema ocjeni izabrati i najpo desnije metode za njihovo otkrivanje. Takav način izbora pruža

Tabela 2
MOGUĆNOST OTKRIVANJA GREŠAKA U NEMAGNETIČNIM ILI LAKIM METALIMA

		Općenito	Limovi i profili	Šipke i cijevi	Odjeljci	Otkivci	Zavari	Obrada	Eksploracija	Ostali materijali
● odlična mogućnost		Površinske pukotine								
● dobra mogućnost		Unutrašnje pukotine								
○ slaba mogućnost		Unutrašnje greške								
		Mjerenje debiljine								
		Metaličke promjene								
		Debiljina								
		Dovoljnost								
		Supline (greške)								
		Uzdužne braze								
		Cijevni oblici								
		Lokalna zadržavanja								
		Uključici								
		Pukotine na hladno								
		Površinske pukotine								
		Unutrašnje skupljanje								
		Rupitčevosti-poroznost								
		Uklanjanje jezgre								
		Preklopni								
		Uključici								
		Unutrašnje prskotine								
		Uključici i napravine								
		Pukotine od skupljanja								
		Uključici slijake								
		Nedovoljno vezivanje								
		Poroznost								
		Nedovoljna penetracija								
		Pukotine od brušenja								
		Pukotine od umornosti								
		Naponska korozija								
		Mehurčavost								
		Smanjenje debiljine								
		Koroziski zajedi								
		Staklo								
		Porculan (glazirani)								
		Plastične mase								
		Debilija zaštinog prenaza								
		Nedovoljno sljubljivanje								

sigurnost i efikasnost kontrole uz najmanje troškove za njeno provođenje.

Metode vizuelnog pregleda služe, osim za kontrolu vanjskog izgleda, i za ustanavljanje kvaliteta obrade površina. Budući da se ovakvi pregledi vrše po pravilu prilikom kontrole dimenzija, one su obrađene na drugom mjestu u ovoj enciklopediji.

METODE PROZRAČAVANJA

Fizičke osnove i principi ispitivanja prozračavanjem. Za provođenje ispitivanja metodama prozračavanja upotrebljavaju se gotovo isključivo X-zrake (rendgenske) i gama- (γ -) zrake. Rendgenske ili X-zrake nastaju kao posljedica naglog kočenja ubrzanog snopa elektrona na metalnoj ploči (antikatodi u rendgenskoj cijevi). Gama-zrake nastaju prilikom spontanog raspada nestabilnih atomskih jezgri (prirodnih radioaktivnih materijala i radioaktivnih izotopa). Oba zračenja su u biti elektromagnetska zračenja određenih raspona valne dužine i imaju sve karakteristike takvog zračenja (prelamanje, odbijanje, polarizacija, difracija, brzina širenja).

Kada elektron sa kinetičkom energijom eV udari u antikatodu katodne cijevi, može nastati nekoliko tipova transformacije energije. Najjednostavniji je sraz elektrona s atomskom jezgrom strukture antikatode. Zbog velikih razlika u masama energija elektrona se transformira u kvant radijacije sa minimalnom valnom dužinom

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV},$$

gdje je h Planckova konstanta, c brzina svjetlosti, e naboj elektrona, V potencijal između katode i antikatode. Ako se u gornju jednadžbu uvrste brojne vrijednosti veličina h , c i e , dobije se za minimalnu valnu dužinu, u angstromima ($1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$):

$$\lambda_{\min} = (12,395/V) \text{ \AA}.$$

Najveći broj elektrona, međutim, sudara se s elektronima iz atomske strukture antikatode i izbija ih iz ljske trošeći pri tome samo dio svoje kinetičke energije. Ako se ovi elektroni naglo zaustave, njihova ostatna energija transformira se u kvante radijacije s valnim dužinama $\lambda > \lambda_{\min}$. Tako nastaje spektar radijacije X-zraka. Ovaj je spektar kontinuiran. Stanje atoma iz čije su ljske izbijeni elektroni nestabilno je; ono prelazi u stabilno stanje time što dio ubrzanih elektrona smanjene energije nadomešta izbijene elektrone. Atom oslobođa pri tome jedan

ili više fotona sa energijom $h c/\lambda$, valne dužine karakteristične za element od kojega je načinjena antikatoda. Tako nastaju tzv. karakteristične spektralne linije (v. Rendgenski spektar u članku *Atom*, TE 1, str. 457). Najveći dio energije ubrzanih elektrona pretvara se kod zaustavljanja u toplinsku energiju. Zbog toga se fokusna površina jako zagrije.

Karakteristike zračenja u rendgenskom spektru zavisne su od upotrijebljjenog potencijala. Kod malih potencijala ($20\text{--}60 \text{ kV}$) zračenje je izrazito »meko«, prenosi malu energiju, a kod vrlo visokih potencijala ($> 1000 \text{ kV}$) vrlo »tvrdi«, tj. bogato energijom.

Atomi nekog elementa koji se razlikuju po broju neutrona u jezgru nazivaju se izotopima. Takvi se atomi razlikuju po atomskoj težini, ali su im kemijska svojstva jednakia. Izotopi se danas vještački stvaraju »bombardiranjem« neutronima, protonima, X-zrakama visokih energija ili nekim drugim subatomskim česticama. Neke od jezgara tako dobivenih izotopa (kao i jezgre nekih prirodnih elemenata) nisu stabilne i raspadaju se. Tokom procesa raspada njegove jezgre, takav izotop zrači energiju, radioaktivan je, te se zato naziva radioaktivnim izotopom ili, skraćeno, radioizotop. Jedan dio oslobođene energije, veći ili manji prema izotopu koji se raspada, zrači se u obliku gama-zraka. U defektoskopiji upotrebljavaju se radioizotopi pri čijem je raspodu udio gama-zračenja velik, kao kobalt-60 i cezijum-137.

Kod jedne vrste raspada jezgre nastaju uvijek iste vrste gama-kvanta određenih energija. Radioizotopi zbog toga ne emitiraju zračenje kontinuiranog spektra nego se u spektru njihova zračenja pojavljuju samo linije (linijski spektar).

Ako u nekoj masi radioizotopa ima N radioaktivnih jezgri, u vremenu $d\tau$ raspast će se dN jezgri:

$$dN = \lambda' N d\tau,$$

gdje λ' označava karakterističnu konstantu. λ' je mjeru za svojstvo izotopa koje se naziva njegovim aktivitetom. Iz jednadžbe

$$\lambda' = \frac{dN}{N d\tau}$$

slijedi da λ' predstavlja udio broja raspada (raspalih jezgara) u jedinici vremena u odnosu na ukupni broj na početku prisutnih jezgara i da je dimenzija aktivitet $[\lambda'] = \text{T}^{-1}$, tj. u sistemima CGS i MKS njegova je jedinica s^{-1} (broj raspada na sekundu). Više se uobičajila specijalna jedinica aktiviteta zvana kiri (curie) definirana kao

$$1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}.$$

(To odgovara aktivitetu količine od $0,66 \text{ mm}^3$ radona, pod standardnim uvjetima, u ravnoteži s 1 g radijuma.)

Integriranjem jednadžbe (1) dobiva se:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t},$$

zakon radioaktivnog raspada, koji kaže koliko se je jezgara od na početku prisutnih raspalo za vrijeme t . S pomoću te jednadžbe definira se veličina koja se namjesto λ često upotrebljava za karakterizaciju radioaktivnih tvari, tzv. vrijeme poluraspada $t_{1/2}$, tj. vrijeme koje je potrebno da bi se raspala polovica ispočetka prisutnih jezgara. Iz jedn. (2) slijedi, sa $N = 0,5 N_0$: $t_{1/2} = 0,693/\lambda$.

U defektoskopiji se upotrebljavaju isključivo radioizotopi jer su neuporedivo jeftiniji od prirodnih radioaktivnih elemenata.

Tablica 3
KARAKTERISTIKE GAMA-IZVORĀ

Radioizotop	Vrijeme poluraspada	Energija radijacije, MeV		Metoda dobivanja	Specif. vol. ak-tivnosti, Ci cm ⁻³	Gama radijacija R h m Ci ⁻¹	Ekviv. radija: 1 Ci odgovara g	Vrijednost poludebljine mm Pb
		β	γ					
Co-60	5,3 godina	0,31 (100%)	1,33 (100%) 1,17 (100%)	⁶⁰ Co (n, γ) ⁶⁰ Co	620	1,35	1,6	13
Ir-192	74,4 dana	0,24 (11%) 0,54 (41%) 0,67 (48%)	brojne od 0,137 do 0,651	¹⁹¹ Ir (n, γ) ¹⁹² Ir	370	0,55	0,65	2
Cs-137	30 ± 3 god.	1,17 (8%) 0,51 (92%)	0,66 (100%)	proizvod radioaktivnog raspada	100	0,39	0,42	8

Tablica 3 prikazuje usporedne karakteristične veličine za tri najčešće upotrebljavana radioizotopa: kobalt-60 (⁶⁰Co), iridijum-192 (¹⁹²Ir) i cezijum-137 (¹³⁷Cs).

U defektoskopiji prozračavanjem nije moguće praktično koristiti se pojedinačna prelamanja i totalne refleksije X- i gama-zraka jer ne postoje tehnička sredstva (leće, prizme, zrcala) kojima bi se ove zrake mogle skupljati ili usmjeravati. Kao i vidljivo svjetlo, X- i gama-zrake prolaze pravocrtno kroz materijal uz pojavu djelomične apsorpcije. Zavisno od valne dužine (energije kvanta zračenja) proces apsorpcije može biti posljedica triju različitih efekata: foto-efekta, Comptonovog efekta i procesa stvaranja parova elektrona. Kod fotoefekta se X- ili gama-kvant u potpunosti apsorbira, a izbija se ubrzani elektron — *fotoelektron*. U Comptonovom efektu dolazi do kvanta promijenjenog smjera s energijom manjom od energije primarnog X- ili gama-kvanta. Javlja se i ubrzani elektron, tzv. Comptonov elektron. Procesom stvaranja parova kvant se potpuno apsorbira a nastaju ubrzani pozitron i elektron (v. također *Biološki štit*, TE 2, str. 84, i *Dozimetrija ionizujućeg zračenja*).

Rasipane zrake apsorbiraju se u materiji također uz pojavu navedenih efekata. Što je duži put rasipanih kvanta u materijalu veća je i vjerojatnost ponovnog i daljnog rasipanja. Intenzitet i kvalitet zraka rasipanih prilikom prolaza kroz neki materijal zavisi od geometrije prozračavanog komada (*volumski efekti*). Efekt ovih zraka u materijalu je isti kao efekt ubrzanih elektrona na antikatodi rendgenske cijevi. Rasipno zračenje i zračenje nastalo kao posljedica foto-elektrona, Comptonovog elektrona i elektrona iz procesa tvorbe parova, zove se zajedničkim imenom *sekundarno zračenje*.

Intenzitet zraka opada po dubini prozračavanog materijala. Ako je debljina materijala koji prozračavamo d , intenzitet zraka na izlazu iz materijala bit će

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu d} \quad [I = I_0 \exp(-\mu d)],$$

gdje je I_0 ulazni intenzitet zraka, I intenzitet na izlazu iz materijala a μ linearni koeficijent apsorpcije, direktno proporcionalan četvrtoj potenciji atomskog broja prozračavanog materijala i trećoj potenciji valne dužine primarnih zraka.

Kod prozračavanja materijala zračenje će, međutim, biti sačuvano od više komponenata različitih valnih dužina primarnih zraka uz jako prisustvo sekundarnih zraka nastalih u procesu apsorpcije. Zakon apsorpcije ovakvog zračenja može se prikazati izrazom

$$I_d = I_0 B \cdot \exp(-\mu_{ef} d),$$

gdje je I_d intenzitet primarnih i sekundarnih zraka nakon prolaza kroz materijal, I_0 intenzitet svih primarnih zraka, μ_{ef} efektivni apsorpcijski koeficijent, a B tzv. »build up« faktor. Ovaj faktor je funkcija geometrije prozračavanog materijala i približno je:

$$\text{za čelik } B_{Fe} = (1 + \mu_{Fe} \cdot d), \text{ za olov } B_{Pb} = \frac{(1 + \mu_{Pb} \cdot d)}{2}.$$

Zrake veće valne dužine (kvanti manjih energija) brže se apsorbiraju u materijalu od zraka manje dužine vala. Zbog toga je njihov udio u spektru zračenja s porastom debljine sve manji. Ova se pojava naziva *filtracijskim efektom* materijala. Filtracijski efekt je naročito izražen kod materijala velikih atomske težine. U praksi se to iskorištava pri upotrebi olovnih folija za reduciranje sekundarnog zračenja.

Tablica 3

KARAKTERISTIKE GAMA-IZVORĀ

Greška koja se eventualno nalazi u prozračavanom materijalu ima sigurno atomski broj različit od atomskog broja materijala. Po pravilu je (naročito kod prozračavanja čelika i težih metala) ova razlika znatna. Zbog toga će, a prema gornjim izrazima, intenzitet zraka koji prolazeći kroz materijal naidu na grešku biti različito umanjena, te će se moći na izlazu iz materijala registrirati ili mjeriti. Ovo svojstvo predstavlja osnovu defektoskopske kontrole metodama prozračavanja.

Područje upotrebe metoda prozračavanja. Od svih tehnika defektoskopskog pregleda metodama prozračavanja najrasprostranjenija i najviše upotrebljavana je *filmska radio- ili gamagrafija*. Intenzitet zraka na izlazu iz materijala stvara na filmu jaču ili slabiju latentnu sliku koja se nakon razvijanja očituje kao vidljiva razlika u zacrnjenju filma.

Tehnika fluorografije zasnovana je na principu fluorescencije zaslona od odgovarajućeg materijala (npr. cink-sulfida ZnS), kada na njega padnu X- ili gama-zrake nakon prolaska kroz ispitivani materijal. Mjesta grešaka u materijalu očituju se kao svjetlje mrlje na zaslonu. Nedostatak ove tehnike je relativno velika neoština, pa se zbog toga dosta rijetko upotrebljava u industrijskoj defektoskopiji.

Kseroradiografska tehnika osniva se na promjeni vodljivosti poluvodiča pod djelovanjem zračenja. Eksponirane ploče razvijaju se posipavanjem posebnim praškovima, a slika se pojavljuje u obliku reljefa. Ova tehnika, zbog svoje prilične komplikiranosti, uglavnom nije izašla iz okvira laboratorijske primjene.

Tehnika prozračavanja s upotrebom Geiger-Müllerovih, scintilacionih brojača itd. u novije se vrijeme sve više upotrebljavaju. Njihovo područje upotrebe, međutim, strogo je ograničeno na neke velikoserijske ili masovne proizvodnje sa specijalnim, skupim uredajima (većinom vezanim sa rekorderima, automatikom i signalizacijom) bez kojih ne mogu biti normalno u upotrebi.

Filmska radiografija ima nekoliko osnovnih prednosti koje su uvjetovale njenu vrlo široku primjenu u industrijskoj defektoskopiji. Najvažnije prednosti jesu: a) dobra vidljivost površinskih, potpovršinskih i unutrašnjih grešaka; savremenim razvojem na učućih saznanja i tehničkih mogućnosti za ovu tehniku omogućeno je pouzdano otkrivanje i određivanje grešaka kojih veličina ne prelazi 1,5 do 2% debljine prozračavanog materijala; b) ovom tehnikom dobiva se trajan dokument (film) kojim se može naknadno utvrđivati i uspoređivati nivo kvaliteta kontroliranog predmeta; to predstavlja naročitu pogodnost kad kvalitet proizvoda kontrolira-

DEFEKTOŠKOPIJA

lira osim kontrolnog organa proizvodača još i neko drugo kontrolno ili inspekcijsko tijelo, ili kad treba usporediti kvalitet proizvoda (npr. posuda pod pritiskom, mostova) odmah po proizvodnji i nakon određenog vremena eksploatacije; c) ovom su tehnikom snimanje i interpretacija rezultata vremenski odijeljeni, stoga za provođenje ovog tipa kontrole nije potreban velik broj visokostručnog ili visokospecijaliziranog kadra: snimanje i obradu filma može vršiti priućeni radnik, a specijalisti uglavnom određuju elemente kontrole i pregledavaju slike; d) kod proizvodnje većeg broja istih dijelova ili proizvoda istih ili sličnih debljina stijenki ovom tehnikom omogućen je rutinski rad, a upotrebom panoramskog snimanja može se istovremeno kontrolirati veći broj proizvoda ili veća površina.

Pored navedenih prednosti, metode prozračavanja imaju i određena ograničenja u industrijskoj upotrebi i izvjesne nedostatke. To su, uglavnom, ovi:

a) Uredaji za provođenje kontrole metodama prozračavanja relativno su skupi, pribor za snimanje i pregled filmova zahtijeva stalno nova finansijska ulaganja, uredaji za zaštitu od zračenja i tamna komora za obradu filmova također predstavljaju velike investicione troškove. Prema tome upotreba ovih metoda ograničena je uglavnom na veće tvornice, u kojima je omogućeno njihovo korištenje za kontrolu cijelog proizvodnog programa ili bar većine proizvoda, ili velike specijalizirane defektoskopske laboratorije koje vrše također usluge za manje tvornice ili tvornice koje trebaju kontrolu samo malog dijela proizvoda ovim metodama.

b) Cijena filma i ostalog potrebnog potrošnog pribora te amortizacija investicionih ulaganja ograničava upotrebu ovih metoda kontrole na proizvode s većom pojedinačnom vrijednošću. Prema novijim podacima udio ukupnih troškova kontrole kod vrlo visokih klasa proizvoda (avijacija, energetika, atomska energija) ne prelazi vrijednost od 25% cijene takvih proizvoda. Udio cijene kontrole u ukupnoj cijeni jednostavnijih proizvoda, koji se izrađuju masovno, mora biti znatno niži.

c) Debljina prozračavanog proizvoda također predstavlja izvjesno ograničenje. S porastom debljine rastu i potrebe za sve jačim

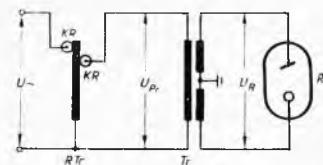
u debljini. Zacrnjena filma najpovoljnija za dobru ocjenu snimke kreću se između $S = 1,5$ i $S = 2,5$. U slučaju veće razlike u debljini stijenke razlika u zacrnjenu na filmu bit će tolika da će otežati ili onemogućiti interpretaciju rezultata kontrole. Praktički maksimalno dopustiva razlika u debljinama stijenki kod upotrebe rendgena iznosi $\sim 20\%$. Pri upotrebi radioizotopa dopustiva razlika je nešto veća.

e) Određeni tipovi grešaka male debljine (npr. pukotine, dvoslojnost), postavljenih poprečno na smjer zračenja, vrlo se teško otkrivaju metodama prozračavanja.

Uredaji, pribor i postupci ispitivanja prozračavanjem.

Moderni uredaji za emitiranje X-zraka (rendgenski aparati, »rendgeni«) proizvode se danas u velikom broju tipova. U tablici 4 navedeni su samo neki najuobičajeniji od njih. Klasični rendgenski aparati proizvode se za srednje energije (80...400 kV maksimalne energije) i to uglavnom u dvije osnovne izvedbe: kao lako prenosivi, tzv. poluvalni, i kao stacionarni — istosmjerni. Osim klasičnih rendgenskih aparata, u defektoskopiji se upotrebljavaju kao izvori X-zraka također visokonaponski rendgenski aparati i betatron.

Poluvalni rendgen-aparati. Pojednostavnjenu shemu poluvalnog rendgenskog aparata prikazuje slika 1. Mrežni napon U prilagođuje se kliznim regulatom KR na regulacionom transformatoru RTr, koji istovremeno služi za regulaciju napona U_{Pr} na primarnom namotaju visokonaponskog transformatora Tr. Krajevi sekundarnog namotaja visokog napona U_R spojeni su s rendgenskom cijevi R. Visokovakuumska rendgenska cijev djeluje kao ventil i emitira struju elektrona samo u poluperiodi kad antikatoda (anoda) ima prema katodi pozitivni potencijal. Zbog iskoristenja samo jedne poluperiode (polovice jednog vala) ovakav spoj, a prema njemu i aparat, zove se poluvalni.



Sl. 1. Shema poluvalnog rendgenskog aparata

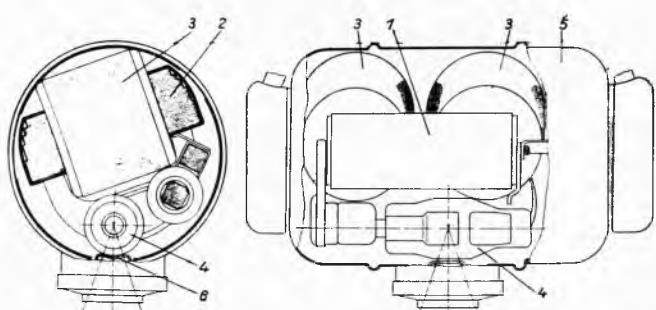
Tablica 4
PODRUČJA OPTIMALNE UPOTREBE IZVORĀ ZRAČENJA

Vrsta zračenja	Izvor zračenja	Debljina prozračavanja mm Fe		Faktor množenja za				
		rutinski rad	max.	Al	Cu	Zn	Mjed	Pb
X	Poluvalni rendgen	100 kV	0...8	15	12	0,67	—	—
	" "	150 kV	0...20	40	7,7	0,62	0,71	0,71
	" "	200 kV	6...30	60	7,1	0,71	0,75	0,77
	Istosmjerni rendgen	300 kV	6...50	100	—	0,71	0,77	—
	" "	400 kV	10...75	125	—	0,71	0,77	0,77
	Rezonantni transformator	1 i 2 MV	50...125	200	—	—	—	0,83
γ	Van de Graaff generator	1 i 2 MV	50...125	200	—	—	—	0,83
	Linearni akcelerator	3...8 MeV	70...200	250	—	—	—	0,2
	Betatron	8...35 MeV	70...250	400	—	—	—	0,4
γ	Co-60	30...100	200	2,9	0,91	1,0	0,91	0,43
	Cs-137	15...75	120	2,9	0,91	1,0	0,91	0,36
	Ir-192	8...50	100	2,9	0,91	0,91	0,91	0,25

(i skupljim) uredajima, koji bi bili sposobni kontrolirati određenu količinu proizvoda kroz prihvatljivo dugo vrijeme. U tablici 4 dat je pregled izvora sposobnih za defektoskopiju određenih debljina u čeliku. Maksimalne vrijednosti debljina prozračavanja iz tablice mogu se postići jedino ekstremnim snagama izvora i vrlo dugim vremenima ekspozicije uz upotrebu (za rendgene) visoko-pojačavajućih solnih folija. Za ostale materijale, zbog različitog koeficijenta apsorpcije, može se tablica 4 upotrijebiti (osim za maksimalne vrijednosti) ako se vrijednosti debljine pomnože s koeficijentima, *ekvivalentima čelika*, navedenim za nekoliko neželjeljivih metalova. Ostali elementi snimanja (razmak izvor-film, vrijeme ekspozicije itd.) ostaju pri tom nepromijenjeni. S povećanjem debljine prozračavanog materijala naglo raste i vrijeme ekspozicije. To je naročito izraženo pri upotrebi gama-izvora. Prilikom kalkuliranja broja potrebnih uredaja za predviđenu količinu kontrole treba ovaj moment imati posebno u vidu.

d) Defektoskopija prozračavanjem u izvjesnoj je mjeri nepodesna za kontrolu proizvoda čije stijenke pokazuju velike razlike

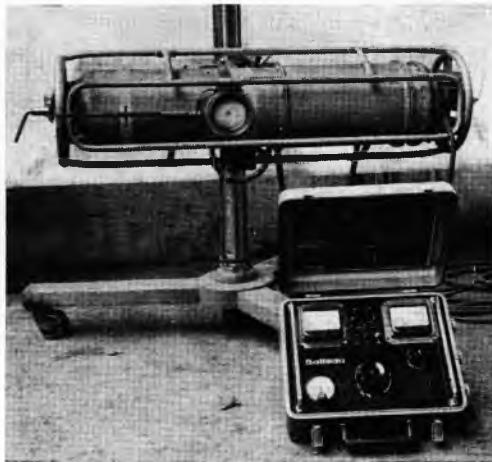
Glavne odlike poluvalnih rendgenskih aparata jesu male dimenzije i reducirana težina, tako da su vrlo pogodni za transport. Mogućnost transportiranja uvjetovala je posebna tehnička rješenja i robustnost izrade radi odolijevanja udarcima tokom prevoza.



Sl. 2. Polushematski presjek zračnika poluvalnog rendgenskog aparata

Dio rendgenskog aparata u kojem se nalazi rendgenska cijev naziva se *zračnikom*. Zračnik se poluvalnih aparata (sl. 2) obično sastoji od visokonaponskog transformatora (1) sa posebno izvedenom zatvorenom jezgrom (2) i namotajima (3), rendgenske cijevi (4), transformatora za grijanje katode rendgenske cijevi i dobro zabrtvijenog kućišta (5) na kojem se nalazi prozor za prolaz izlazećeg zračenja (6). Gabaritne dimenzije kućišta zračnika svih suvremenih poluvalnih aparata u poprečnom presjeku su reducirane na veličinu standardiziranih otvora za prolaz čovjeka na tlačnim posudama, koji ima oblik elipse 300×400 mm. Ulje visoke otpornosti na probaj kojim je zračnik obično punjen (pod vakuumom, kako bi se izbjeglo da u zračniku zaostane zrak) ima svrhu da električki izolira i da prenosi toplinu radi efikasnijeg hlađenja. Za bolje hlađenje antikatode neki tipovi poluvalnih rendgena imaju ugradenu u zračnik i malu cirkulacionu pumpu koja injektira ulje u posebne kanale u rendgenskoj cijevi. U najnovije vrijeme zračnički nekih tipova poluvalnih aparata manjih energija hlađe se plinom.

Zračnik je višežilnim kabelom niskog napona, dužine obično 10–30 metara, spojen s kontrolno-komandnom tablom. Zbog lakšeg prenošenja ova se izvodi u obliku kovčega. Na kontrolno-komandnoj tabli nalaze se ručice za podešavanje i instrumenti za kontrolu mrežnog napona, primarnog napona visokonaponskog transformatora i struje u rendgenskoj cijevi, mrežni prekidač,

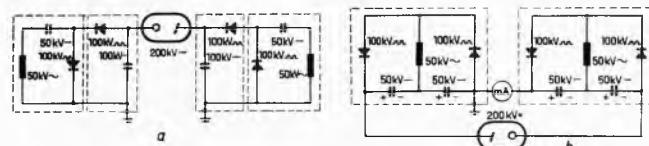


Sl. 3. Poluvalni rendgenski aparat Baltospot 3005/5D.
Zračnik aparata hlađen Freonom

prekidač (indirektni) visokog napona i sat za ekspoziciju. Izgled rasporeda komandi i instrumenata za kontrolu na tabli poluvalnog aparata 300 kV prikazan je na sl. 3.

Zračnici poluvalnih aparata osim za usmjereno zračenje provode se i za tzv. panoramsko snimanje. Antikatoda rendgenske cijevi ovih aparata izvedena je u obliku plašta stoča. Zračenje je po cijelom opsegu s kutom snopa X-zraka najčešće od 15 do 45°. Cijev je izduženog oblika i ima koničnu antikatodu na kraju. Antikatoda je hlađena odvojenim zatvorenim cirkulacionim sistemom s izmjenjivačem topline, a medij za hlađenje je voda. Osim sistema s isturenom anodom postoji i izvedbe s panoramskom antikatodom u centru zračnika. Ovakve izvedbe obično nemaju posebnog hlađenja. Zračnici za panoramsko snimanje imaju prednost u upotrebi kod cilindričnih oblika (kolonā, posudā pod pritiskom i sl.) i za istovremeno snimanje većeg broja jednakih proizvoda malih dimenzija, jer se tim simultanim snimanjem postiže ušteda vremena.

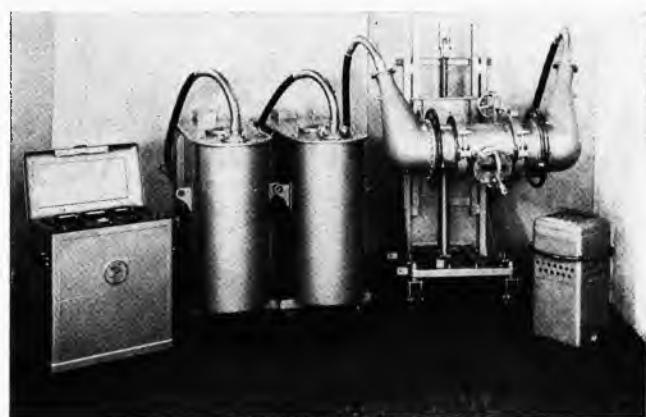
Istosmjerni rendgen-aparati. Osnovni nedostatak poluvalnih aparata, intermitentni rad zbog toga što se koristi samo pozitivna poluperioda, uspješno je uklonjen kod istosmjernih aparata. Danas se istosmjerni aparati srednje snage (do 400 kV) izvode u dva principijelno različita spoja, ali s približno istim efektom. *Villardov spoj* (sl. 4a) u stvari je osnovni spoj za postizanje udvojeneog istosmjernog pulzirajućeg napona s dodatkom za smanjenje amplitude pulziranja, a *Greinacherov spoj* (sl. 4b) ispravlja obje poluperiode izmjeničnog napona uz istovremeno udvajanje napona.



Sl. 4. Sheme spoja istosmjernih rendgenskih aparata. a Villardov spoj s dodatkom za izgladljivanje, b Greinacherov spoj

U oba spoja ispravljanje se vrši visokovakuumskim ispravljačicama (ventilskim cijevima) ili, u najnovije vrijeme, pomoću silicijumskih dioda.

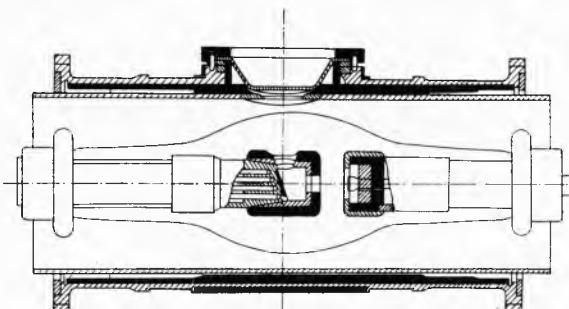
Visokonaponski transformatori, ventilske cijevi i kondenzatori za udvajanje visokog napona istosmjernih aparata ugradeni su u zasebne dobro zabrtvljene posude ispunjene uljem visoke otpornosti na probaj. Svaki aparat ima dva ovakva generatora visokog napona (sl. 5), jedan s pozitivnim a drugi s negativnim potencijalom na vanjskom izvodu (v. i sl. 4). Rendgenska cijev je spojena



Sl. 7. Sastavni dijelovi istosmjernog rendgenskog aparata (Seifert-Isovolt 400). Slijeva nadesno: kontrolno-komandni stol, generatori visokog napona, zračnik sa stativom i pumpa za hlađenje antikatode

s generatorima pomoću savitljivih specijalnih kablova. Na krajevima cijevi nalazi se, dakle, napon jednak sumi potencijala obaju generatora.

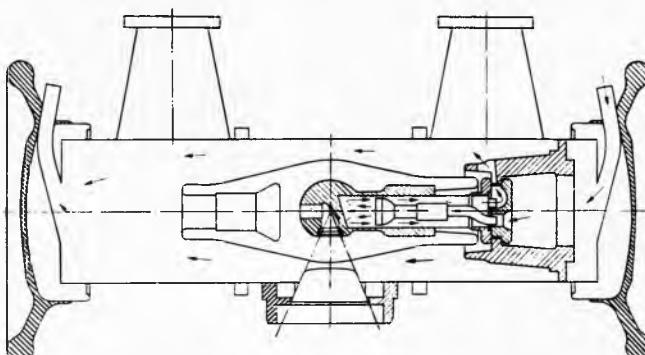
Rendgenska cijev istosmjernih aparata, za razliku od cijevi poluvalnog aparata, ima neprekidan tok elektronskog mlaza na antikatodi. Time je antikatoda toplinski daleko više opterećena, pa je bilo potrebno pobrinuti se za uspješno odvodenje topline. To se izvodi na više načina, od kojih je jedan prikazan na sl. 6. Medij za hlađenje antikatode, najčešće ulje, crpe se iz posebnog rezervoara pumpom i brizga kroz sapnice na stražnju stijenku antikatode. Ulje preuzima na sebe dio topline i vraća se kroz povratne



Sl. 6. Presjek zračnika istosmjernog rendgenskog aparata. (Vide se kanaли za prolaz ulja kojim se hlađi antikatoda.)

kanale u rezervoar. Zračnik aparata, u kojem se nalazi samo rendgenska cijev sa priključcima, ispunjen je uljem za izolaciju i hlađenje, i dobro je zabrtvijen. Sličnu konstrukciju, ali u kojoj sva količina ulja iz zračnika i rezervoara sudjeluje u odvodenju topline, prikazuje sl. 7. Ulje iz rezervoara najprije se posebno konstruiranim kanalima brizga na antikatodu, a nakon toga prolazi kroz zračnik i vraća se u rezervoar.

Istosmjerni aparati redovito se izvode za usmjereni zračenje. No postoje i izvedbe u kojima se upotrebljava samo jedan generator visokog napona (minus-pol) s posebno konstruiranim zračnikom za panoramsko zračenje, a antikatoda rendgenske cijevi je uzemljena.



Sl. 7. Sistem hlađenja zračnika s potpunom cirkulacijom (TUR M200 — VEB Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden)

Kontrolno-komandni stolovi istosmjernog aparata i poluvalnog aparata ne razlikuju se u načelu, ali stol istosmjernog aparata ima više kontrola, redovito svjetlosnih (uključena pumpa za ulje, kontrola cirkulacije ulja, kontrola uključenog grijanja katode itd.), i dosta velik broj sigurnosnih ili razvodnih relaja za osiguranje od eventualnih nepravilnosti u radu aparata.

U posljednjih nekoliko godina za hlađenje i izolaciju zračnika ulje se uspješno zamjenjuje inertnim plinom. Tako firma Balteau iz Belgije proizvodi aparat od 320 i 400 kV u tzv. »monatank«-izvedbi, bez visokonaponskih generatora, gdje su svi visokonaponski dijelovi ugradeni u zračnik zajedno s rendgenskom cijevi i hlađeni sistemom cirkulacije inertnog plina (Freona) u zračniku. Ovo svakako predstavlja poboljšanje u izvedbi, jer su visokonaponski kabeli najosjetljiviji dio istosmjernih rendgenskih aparata.

Visokonaponski rendgen-aparati. Za veće energije zračenja grade se u svijetu dva tipa visokonaponskih rendgenskih aparata. U industrijskoj primjeni u Evropi nalazi ih se vrlo malo, ali su u USA dosta rašireni. To su rezonantni transformator i van de Graaffov generator. Oba se temelje na principu linearnog ubrzavanja elektrona, a razlikuju se po tome što rezonantni transformator emitira intermitirajuće zračenje kao poluvalni rendgenski aparat, a emitiranje van de Graaffova generatora je neprekidno.

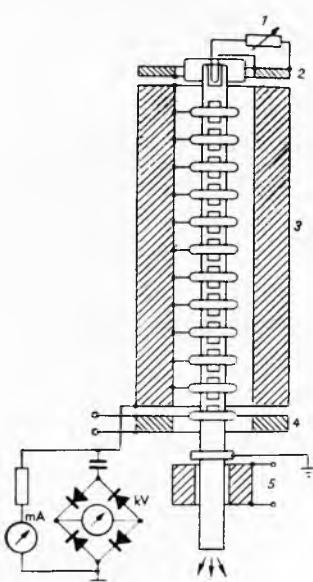
Principijelna shema rezonantnog transformatora prikazana je na sl. 8. Primarni namotaj (4), radi veće indukcije, radi s frekvencijom višom (obično trostrukom) od mrežne. Sekundarni namotaj visokog napona (1...2 MV) podijeljen je na velik broj sekacija induktivno vezanih s primarnom konstrukcijom bez jezgre i spojen sa sistemom ispravljača. U sredini transformatora smještena je rendgenska cijev grijana posebnim namotajem 2. Emitirani elektroni ubrzavaju se sistemom prstenova pod visokim potencijalom, usmjeravaju (fokusiraju) posebnim namotajem 5 i na izlazu iz cijevi udaraju u antikatodu. Cijeli sistem ugrađen je u nepropusnu posudu punjenu freonom, koji pomoću pumpe cirkulira i hlađi, a istovremeno djeluje kao električki izolator.

Princip rada van de Graaffova generatora objašnjen je na drugom mjestu u ovoj enciklopediji (v. *Akceleratori nuklearnih čestica*, TE 1, str. 40). Izgled izvedbe jednog van de Graaffova generatora za defektoskopiju 2 MW prikazan je na sl. 9.

Betatron. Dok kod klasičnih rendgenskih aparat i visokonaponskih aparatova ubrzavanje elektrona nastaje kao posljedica naponskog stanja, betatron se zasniva na ubrzavanju elektrona pod utjecajem promjenljivog magnetskog polja. Princip djelovanja betatrona također je veći na drugom mjestu objašnjen (v. *Akceleratori nuklearnih čestica*, TE 1, str. 42). Stepen iskoristivosti energije za betatron daleko je veći nego za rendgen. Dok se od ukupno emitirane energije rendgenskog aparat jedva 2% pretvara u zračenje, za betatron od 15 MeV ovaj udio iznosi 40%. Za potrebe defektoskopije u svijetu se proizvode betatroni energije 5...35 MeV. Sl. 12 prikazuje tipični defektoskopski betatron. Betatron za svrhe defektoskopije upotrebljava vrlo mali broj proizvodača, ne samo zbog visoke cijene uredaja, nego i zbog potrebnih golema investicija u sredstva za zaštitu od njegova zračenja.

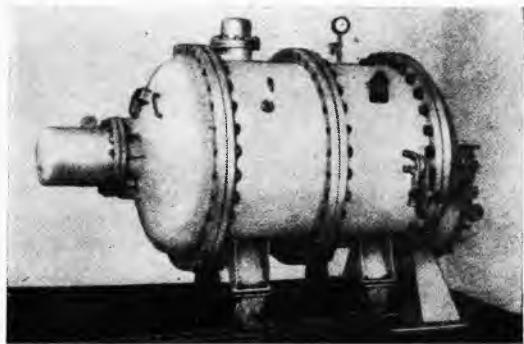
Uredaji za gama-radio-

grafiju. Osnovne prednosti uredaja za prozračavanje pomoću gama-zraka pred rendgenima jesu njihove relativno male dimenzije, njihova transportabilnost i (u većini slučajeva) nezavisnost od izvora električne energije. Eksplotacija gama-izvora zato je došla do punog značaja u kontroli montažnih radova, na cjevovodima, većim konstrukcijama itd., no u novije vrijeme se i njihova upotreba kao stacionarnih uredaja znatno razvila, naročito za izvore velikih energija, zahvaljujući konstrukcijama daljinskih komandi i servo-uredajima za održavanje vremena ekspozicije.



Sl. 8. Shematski prikaz rezonantnog transformatora

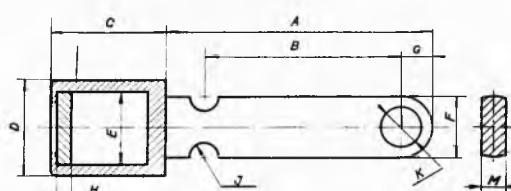
Princip rada van de Graaffova generatora objašnjen je na drugom mjestu u ovoj enciklopediji (v. *Akceleratori nuklearnih čestica*, TE 1, str. 40).



Sl. 9. Van de Graaffov generator 2 MeV za defektoskopiju (VEB Transformatoren- und Röntgenwerke, Dresden)



Sl. 10. Betatron 15 MeV (Chirana, Prag)

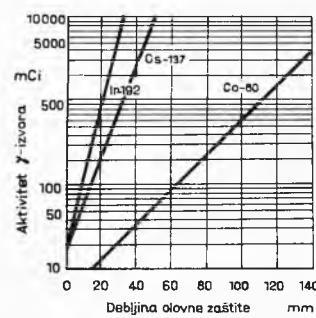


Dimenzije izvora, mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
6 × 6	21	15,5	9	7,2	6	5,1	2,5	1	1,5	3	2
4 × 4	22	15,5	8	5,1	4	5,1	2,5	1	1,5	3	2
2 × 2	23	15,5	7	5,1	2	5,1	2,5	1	1,5	3	2
1 × 1	23	15,5	7	5,1	1	5,1	2,5	1	1,5	3	2

Sl. 11. Aluminijski držač za izvor Ir-192 (Institut 'Boris Kidrić' Vinča)

Osnovu uređaja za defektoskopiju gama-zračenjem predstavlja sam izvor zračenja. Izvor se isporučuje najčešće u obliku valjkaste tablete smještene u poseban držać (kapsulu). Izgled i dimenzije držića za izvore iridijum-192, koje proizvodi nuklearni institut »Boris Kidrić« u Vinči, prikazuju sl. 11. Držaći se izvode od laktih metala te zadržavaju vrlo mali dio zračenja, uglavnom njihovih α - i β -komponenti.

Za razliku od izvora X-zraka, uređaji za rad s izvorima gama-zraka moraju biti posebno konstruirani, s obzirom na to što gama-izvori stalno emitiraju zračenje. Zbog toga se uređaji za gama-defektoskopiju obično izvode u dva zasebna sklopa: *defektoskope i kontejnere*. Za vrijeme stajanja ili transporta, tj. kad se izvor ne upotrebljava, on se nalazi smješten u kontejneru i prebačuje se u defektoskop neposredno prije primjene. Defektoskop i kontejner moraju osiguravati biološku zaštitu rukovača uređajem. To se postiže izvedbom zaštitnog omotača od materijala s velikom atomskom težinom. Debljina zaštitnog omotača zavisi od vrste i aktivnosti radioizotopa za koji je uređaj predviđen i od upotrijebljjenog materijala za zaštitu. U dijagramu sl. 12 nanesene su debljine olovnog zaštitnog omotača u zavisnosti od tipa i aktivnosti izvora, uz pretpostavku da na 1 metar udaljenosti od zatvorenog izvora zračenje nije jače od $2 \mu\text{R}/\text{s}$.



Sl. 12. Debljina olovne zaštite za dozu od $2 \mu\text{R}/\text{s}$ na 1 m udaljenosti

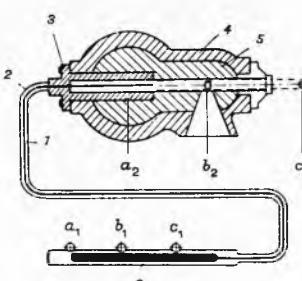
aktivnosti izvora, uz pretpostavku da na 1 metar udaljenosti od zatvorenog izvora zračenje nije jače od $2 \mu\text{R}/\text{s}$.

Zbog manipulativnosti poželjno je da defektoskopi budu malih dimenzija i umjerene težine. Ovaj zahtjev je u suprotnosti s efektivnošću zaštite od zračenja. Uzimajući u obzir činjenicu da namještanje defektoskopa i njegovo otvaranje ne traje dugo i da se osoba koja rukuje izvorom u ostalom vremenu (čekanje tokom eksponiranja, stajanje itd.) nalazi na relativno velikoj udaljenosti od izvora, defektoskopi se konstruiraju tako da propuštaju relativno visoke ekspozicije (doze zračenja). Za jače izvore defektoskopi

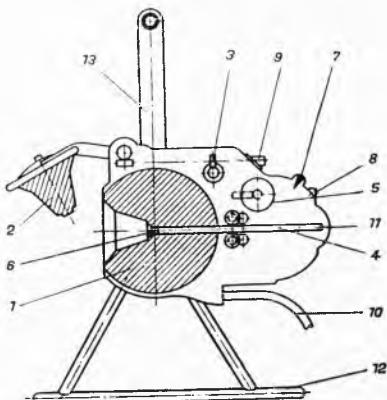
se izrađuju s oblogama od legura teških metala (volframa, urana), čime im se težina a i dimenzije mogu značajno smanjiti. Međutim, velik nedostatak takvih uređaja je njihova vrlo visoka cijena.

Dok se kod izvođenja defektoskopa kao glavni faktor (uz određenu sigurnost) uzima manipulativnost, izvedba kontejnera rezultat je prvenstveno zahtjeva za dobru zaštitu od zračenja. Njihove su dimenzije i težine zato uvijek veće od dimenzija i težine defektoskopa. Modernije izvedbe kontejnera za izvore većih aktivnosti imaju posebno konstruirana transportna kolica. Na sl. 13 prikazani su defektoskop i kontejner proizvodnje »Energo-invest«, Sarajevo, za izvor kobalt-60, aktivnosti 1,0 Ci, s opisima sastavnih dijelova i dijagramima ekspozicije (doze zračenja) u zavisnosti od udaljenosti.

Da bi se spriječile velike ekspozicije prilikom otvaranja i zatvaranja defektoskopa s jakim izvorima, postoji danas čitav niz rješenja za daljinsko upravljanje, počevši od najjednostavnijih mehaničkih pa do komplikiranih potpuno automatskih sistema. Sl. 14 pokazuje jednostavan način manipulacije izvorom iz daljine pomoću savitljivog ka-



Sl. 14. Sistem ručnog daljinskog rukovanja defektoskopom (defektoskop CUP-Co-0,5-J, proizvod SSSR). 1 Čelična žica, 2 savitljivi kabel, 3 čahura od teškog metalra, 4 kucište od ležjeg željeza, 5 olovna ispunja, 6 manipulator; a_1 , b_1 , c_1 položaji ručice na manipulatoru koji odgovaraju odnosnim položajima izvora

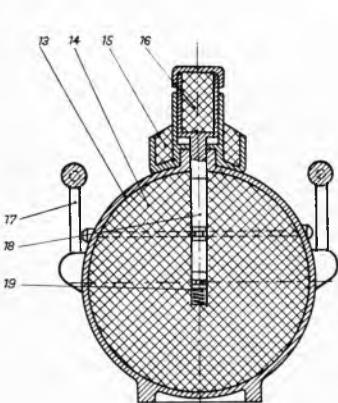
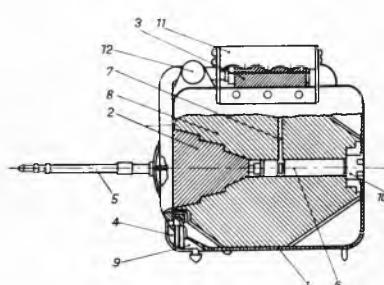


Sl. 15. Električno upravljeni defektoskop »TuR M Co 1,3 (VEB Transformator- und Röntgenwerke, Dresden). 1 Olovno tijelo defektoskopa, 2 olovni poklopac, 3 poluga za otvaranje poklopca, 4 zupčasta letva za izvlačenje izvora, 5 pogonski elektromotor, 6 izvor Co-60, 7 pokizač položaja izvora, 8 priključak na daljinsko upravljanje, 9 zupčasta letva za otvaranje poklopca, 10 ručka za orientiranje defektoskopa, 11 ručica za prenos, 12 stalak, 13 ručica za prenošenje

belu 2 sa čeličnom žicom 1. Položajima ručice a_1 , b_1 , c_1 na manipulatoru 6 odgovaraju određeni položaji izvora smještenog u posebno izvedenoj šipki od teškog metala. U položaju a_2 izvor je neaktiviran, položaj b_2 je predviđen za usmjereni zračenje, a u položaju c_2 izvor je izvučen iz defektoskopa i zrači panoramski.

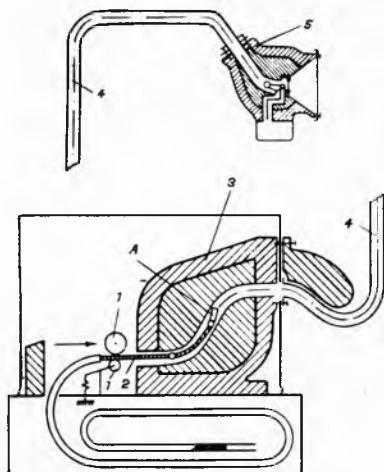
Složeniju konstrukciju daljinskog upravljanja shematski prikazuje sl. 15. Izvor kobalt-60 jakosti 1,3 Ci (6) učvršćen je na zupčastoj letvi 4 pogonjenoj elektromotorom 5 upravljanim iz daljine. Usmjereno zračenje postiže se otvaranjem poklopca 2 pomoću elektromotornog pogona i poluge 3. Potiskivanjem zupčaste letve ulijevo izvor izlazi iz defektoskopa i zrači panoramski. Defektoskop je električkim vodovima spojen s komandnim uređajem na kojem se, osim svjetlosnih oznaka za signaliziranje određenih položaja izvora, nalazi električki sat za ekspoziciju s automatom za zatvaranje nakon proteka odabranog vremena.

Izvori vrlo visokih aktivnosti postavljaju posebne zahtjeve u pogledu zaštite od zračenja ne samo prilikom njihova čuvanja nego također, i prvenstveno, za vrijeme namještanja ekspozicije. Opasnost od velikih doza pri premještanju takvog izvora iz kontejnera u defektoskop izbjegнута je povoljnom konstrukcijom prikazanom na sl. 16. Izvor, izotop



Sl. 13. Presjek defektoskopa JU-DE H 2 (gore) i kontejnera TK-2 (dolje) s dijagramima doza zračenja u zavisnosti od udaljenosti (»Energo-invest«, Sarajevo). 1 Limeni okvir, 2 konusni poklopac, 3 rupica za otvaranje, 4 brava, 5 linear za centriranje, 6 držać izotopa, 7 vijak za učvršćenje držića izotopa, 8 olovni zid, 9 nosač brave, 10 čep defektoskopa, 11 ručica za prenos, 12 osovinski poklopac, 13 brončani omotač, 14 olovna masa, 15 poklopac, 16 klip poklopca, 17 ručica, 18 držać izotopa, 19 opruga

kobalt-60 aktivnosti 50 Ci, u stanju mirovanja nalazi se smješten u kontejneru 3 u položaju A. Defektoskop 5, spojen s kontejnerom preko savitljive cijevi 4 duge ~ 15 m, namješta se na mjesto eksponiranja. Tada se aktivira elektromotor, koji preko potisnog sistema 1 gura savitljivu osovinu 2, na čijem je kraju



Sl. 16. Defektoskop-kontejner za jake izvore (CUP - Co-50-J, proizvod SSSR)

montiran izvor, do defektoskopa. Nakon završene ekspozicije izvor se obratnim putem vraća u kontejner. Masa cijelog uređaja je 700 kg, od čega na defektoskop otpada samo 65 kg.

Pomoćna sredstva za filmsku radiografiju. Najvažniji pribor filmske radiografije je *film*. Za različne tehnike rada, jačine i vrste izvora, debljine i kvalitete prozračavanog materijala i za zadovoljenje zahtjeva za vidljivost detalja, razvijen je u svijetu velik broj tipova filmova. Grubom podjelom mogu se svrstati u 3 osnovne grupe: a) finozrnati, visokokontrastni filmovi za upotrebu s olovnim folijama ili bez njih (često nazivani i »spori« filmovi); b) srednje- ili grubozrnati filmovi za upotrebu s olovnim folijama ili bez njih (nazvani i »brzi« filmovi); c) filmovi za upotrebu s oštrosačavajućim ili visokopojačavajućim solnim folijama. Senzitometrijske krivulje ovih vrsta filmova dosta se razlikuju (vidi još pod *Film*) pa je za svaku vrstu potrebno odrediti tzv. faktore filma za rad sa X- i gama-izvorima. Pri izračunavanju potrebnih elemenata ekspozicije važan je i koeficijent zacrnjena *S*. Normalno upotrebljiva zacrnjena u defektoskopiji kreće se od $S = 1,5$ do $S = 2,5$, gdje jača zacrnjena (naročito kod finozrnatih filmova) daju oštriju definiciju greške.

Folije (zasloni) služe za bolje iskoristavanje energije zračenja pri stvaranju latentne slike. Kod ekspozicije primjenjuju se usko priljubljene uz film. *Olovne folije*, debljine najčešće između 0,02 i 0,15 mm, imaju osnovni zadatak da reduciraju utjecaj sekundarnog zračenja na film, čime pojačavaju kontrast i definiciju. Zbog djelomičnog reflektiranja primarnog zračenja ubrzavaju stvaranje latentne slike i djeluju na povećanje zacrnjena. Ova se pojava naziva *pojačanje*, a izražava se omjerom između vremena ekspozicije filma bez folije i filma uz upotrebu folije. Faktor pojačanja za olovne folije uz izvore malih i srednjih kvantnih energija kreće se oko 3, a uz izvore većih energija (gama-izvore) oko 2. *Solne folije* najčešće su izradene od kalcijum-volframata ili barijum-olovo-sulfata, nanesenih u tankom sloju na kartonsku podlogu ili suspendiranih u foliju od plastične mase. Djelovanje im se temelji na svojstvu navedenih soli da fluorescira, tj. apsorbiraju zračenje istovremeno emitirajući svjetlo. Faktor pojačanja solnih folija za manje energije kvanta vrlo je velik (kod 200 keV iznosi 50–100), a za veće energije naglje pada (kod 2 MeV iznosi 2–4). Folije se ne upotrebljavaju pri radu s vrlo jakim izvorima zbog pojave jakog ogrubljenja i slabe definicije snimka.

Da bi se pojednostavnilo i olakšalo izračunavanje elemenata ekspozicije, u normalnoj praksi se upotrebljavaju ekspozicijski dijagrami i računala.

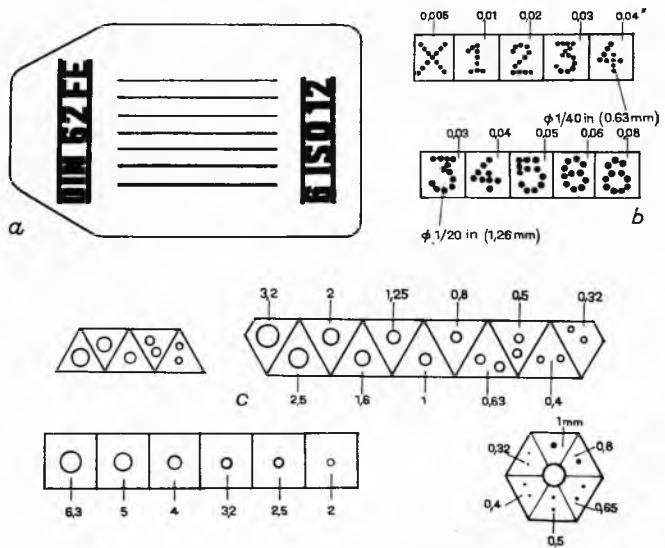
Ostala pomoćna sredstva za filmsku radiografiju jesu: kasete za filmove (metalne i od plastmase), olovna slova i oznake za signiranje pripadnosti snimke, uređaji za razvijanje filmova u

tamnoj komori, ormari za sušenje snimaka, uredaji za čitanje snimaka i pribor za detekciju zračenja.

Pribor za detekciju zračenja, osim sredstava za osiguranje od zračenja (»bunker« za radioizotope, zidani ili obloženi prostori za ekspoziciju; v. i članak *Biološki štit*) predstavljaju neophodan pribor osoblje koje rukuje izvorima zračenja (v. *Detekcija nuklearnog zračenja*). Osim toga osoblje koje radi s izvorima zračenja obavezno nosi na sebi indikatore primjeljene doze (v. članak *Dozimetrija ionizujućeg zračenja*), također za maksimalno dopuštene doze koje u određenom periodu smije da primi profesionalno osoblje.

Interpretacija rezultata ispitivanja prozračivanjem зависи prvenstveno od kvalitet dobivenog snimka, koji se mjeri postignutim stepenom razaznavanja. Pomoćno sredstvo za određivanje stepena razaznavanja jesu indikatori kvaliteta, zvani *penetrametri*.

Na slici 17 a prikazan je indikator kvaliteta prema DIN 54 109. Između folija od plastične mase nalazi se pravilno raspoređeno sedam kalibriranih žica različite debljine (ovi se indikatori izrađuju sa tri područja debljine) od materijala koji približno odgovara materijalu koji se prozračava. Iznad i ispod žica nalaze se olovne oznake s informacijama o materijalu (Fe, Al, Cu) i o području debljine. Razaznavanje se mjeri brojem žica koje se vide na snimku. Osim žičnih indikatora postoji niz izvedbi tzv. stepenastih indikatora kvaliteta snimke. Penetrametar prema BWRA (British Welding Research Association) prikazan je na sl. 17 b, a nekoliko izvedbi prema francuskom standardu AFNOR-NF-04-304 (koji je usvojio i ISO) na sl. 17 c. Brojevi iznad polja označavaju debljinu materijala stepenica. Razaznavanje se mjeri tako da se očitava na



Sl. 17. Penetrametri (indikatori kvaliteta snimka)

snimku posljednja vidljiva razlika između rupe u stepenici i same stepenice.

Definicija razaznavanja *Z* može se prikazati izrazom

$$Z = \frac{\Delta d_{\min}}{d} \cdot 100\%,$$

gdje je Δd_{\min} debljina najtanje žice ili detalja penetrateta koji se još može na filmu opaziti, a d debljina prozračavanog materijala u smjeru zrakâ. Što je manja veličina *Z* to je bolje razaznavanje. Ono zavisi još i od geometrijskih neoština, koje su posljedica odnosa dimenzija izvora i udaljenosti između izvora i filma, i od tzv. unutrašnjih neoština, zavisnih od vrste primijenjenog zračenja i tipa upotrijebljениh folija.

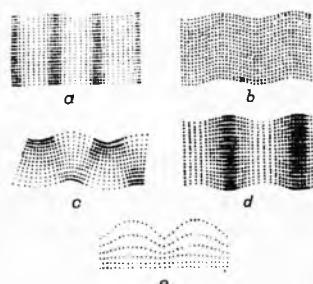
Dobiveni rezultati snimanja grešaka usporeduju se s određenim priznatim *etalonima* ili *standardiziranim veličinama*. Velik broj zemalja razvio je različite tipove standarda za kriterij ocjene grešaka u materijalu; posebno velik broj standarda postoji za odjeljke i zavarene spojeve. Na međunarodnom planu treba istaći aktivnost Međunarodnog instituta za zavarivanje (International Institute of Welding, Institut International de la Soudure — IIW/IIS), čije se kolekcije referentnih radiograma primjenjuju za uspoređivanje rezultata u velikom broju zemalja.

Primjena metoda prozračavanja još je uvijek u stadiju usavršavanja i razvoja. Jednako tako, i usporedo s razvojem metoda ispitanja, u svijetu se vrlo intenzivno radi na stvaranju međunarodno prihvatljivih standarda za ocjenu dopustivih grešaka.

METODE PROZVUČAVANJA

Fizičke osnove i principi ispitivanja prozvučavanjem.

Pod prozvučavanjem razumijeva se danas pronaalaženje grešaka pomoću *ultrazvuka*. Ultrazvukom se nazivaju elastomehanički titraji nekog medija frekvencije iznad 20 kHz, dokle iznad slušnih mogućnosti ljudskog uha. Modernim sredstvima postižu se i emitiraju zvučne frekvencije do ~ 100 MHz, za defektoskopiju ultrazvukom iskorištava se frekventno područje između 0,1 i 25 MHz (najčeće 0,5-6 MHz). Kod većih valnih dužina osjetljivost ispitivanja, naročito malih grešaka, jako opada, a kod frekvencija većih od 10 MHz nastaju jača prigušenja na granicama zrna u metalima, pa je širenje ultrazvučnih valova otežano.



Sl. 18. Tipovi širenja ultrazvučnih valova. *a* Longitudinalni val, *b* transverzalni val, *c* nesimetrični plosnatni val, *d* simetrični plosnatni val, *e* površinski val

U plinovima i tekućinama ultrazvučni valovi gibaju se kao longitudinalni (slika 18 a) u obliku periodski zgušnutih i razrijedenih čestica medija. U čvrstim tvarima energija zvuka može se, osim u obliku longitudinalnog vala, širiti i u obliku transverzalnog vala (sl. 18 b) sa smjerom kretanja čestica poprijeko na smjer širenja vala. Važno je napomenuti da se pri praktičnom korištenju ultrazvukom često susrećemo s pretvaranjem longitudinalnih valova u transverzalne i obrnuto.

Na površini čvrstog uzorka širi se površinski val transverzalnog karaktera (sl. 18e). Brzine longitudinalnog (v_1), transverzalnog (v_t) i površinskog (v_p) vala stoje u približnom odnosu

$$v_1 : v_t : v_p = 1 : 0,55 : 0,50.$$

Putuje li ultrazvuk kroz čvrsti uzorak s jednom ograničenom dimenzijom (npr. lim), mogu se pojaviti i kombinirani valovi,

uslijed kojih cjelokupni medij vibrira u obliku nesimetričnih (sl. 18c) ili simetričnih (sl. 18d) plosnatih valova. U čvrstim uzorcima sa dvije dimenzije vrlo ograničene (npr. šipkama) mogu se pojaviti šipkasti valovi, analogni plosnatim, ili torzionalni valovi.

Brzina širenja longitudinalnih valova iznosi

$$v_1 = \sqrt{\frac{E}{g} \cdot \frac{1 - \sigma}{(1 + \sigma)(1 - 2\sigma)}}$$

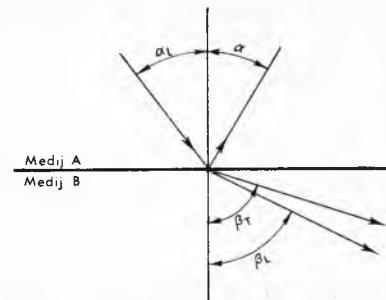
gdje je E modul elastičnosti, ρ specifična masa materijala u kojem se širi zvuk a σ Poissonova konstanta. U tablici 5 navedene su neke od karakterističnih veličina za nekoliko najvažnijih materijala.

Zbog razlike akustičnih impedancija, ultrazvučni val na prelazu između dva medija samo djelomično ulazi u drugi medij, a jedan dio energije odbija se natrag u prvi. Kad val ulazi okomito u novi medij, udio vraćene energije R iznosi

$$R = \frac{(m-1)^2}{(m+1)^2},$$

gdje je $m = Z_1/Z_2 = [(v_1)_1/(v_1)_2] \cdot (o_1/o_2)$.

Ako ultrazvučni val pada na granicu između dva različita medija pod izvjesnim kutom, on se djelomično odbija a djelomično prelama na prelazu u drugi medij. Jedan dio energije u novom mediju se pri tom transformira u transverzalni val. Ovakvo prelamanje može se prikazati izrazima (sl. 19):



Sl. 19. Prelamanje i refleksija ultrazvučnih valova

(Indeksi 1 i 2 odnose se na medije, indeksi 1 i t na longitudinalni odr. transverzalni val.)

Tablica 5

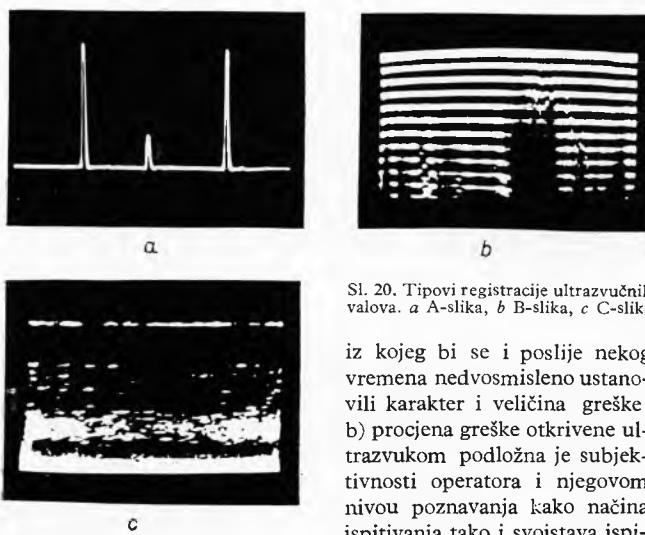
DEFEKTOŠKOPIJA

Kad zvuk upada pod izvjesnim kutovima, dolazi do totalne refleksije kako longitudinalne tako i transverzalne komponente, a mogu nastati i površinski valovi. Ove pojave koriste se kod kutnih glava i tzv. površinskih glava.

Ako ultrazvučni val, prolazeći kroz materijal, naide na grešku, on se (zavisno od veličine, položaja i tipa greške) reflektira od površine greške ili biva, zbog različnih kutova odraza, vrlo umanjen na povratak k površini s koje je emitiran. Mjerenje ovih pojava predstavlja osnovu ultrazvučne defektoskopije.

Područje primjene defektoskopije ultrazvukom. Bez sumnje se može konstatirati da je defektoskopija ultrazvukom zbog svojih prednosti postala vrlo popularna metoda traženja skrivenih grešaka u materijalu. Osnovne prednosti koje ova metoda ima, naročito u usporedbi s metodama prozračavanja, jesu ove: a) područje debljina ispitivanog materijala za ispitivanja ultrazvukom vrlo je veliko; modernim sredstvima mogu se ispitivati materijali debljine i do nekoliko metara; b) uredaji i pribor za rad relativno su jednostavni, lako prenosivi i ne zauzimaju mnogo prostora; c) opasnost od kvarova uredaja smanjena je upotrebom tranzistorske tehnike; time se smanjila i težina uredaja; d) rukovanje uredajima i priborom ne predstavlja nikakvu opasnost za rukovaoca; e) metode defektoskopije ultrazvukom vrlo su osjetljive i otkrivanje grešaka (uz određena ograničenja) dosta je jednostavno; f) moguće je ispitivanje prilazom samo s jedne strane ispitivanog predmeta; g) dodavanjem odgovarajućih uredaja mogu se stvoriti brojne kombinacije za automatizaciju kontrole. Ova se može izvesti u različitoj mjeri: kao automatska registracija, automatsko označavanje defektnih produkata ili mjesta i automatsko sortiranje proizvoda.

Medu ozbiljnije nedostatke ove metode mogu se ubrojiti ovi: a) osim u nekim sasvim specijalnim tipovima ispitivanja (C-slika) metode ultrazvučnog pregleda ne mogu ostaviti trajan dokument



Sl. 20. Tipovi registracije ultrazvučnih valova. a A-slika, b B-slika, c C-slika

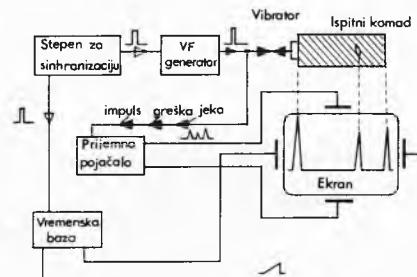
iz kojeg bi se i poslije nekog vremena nedvosmisleno ustanovali karakter i veličina greške; b) procjena greške otkrivene ultrazvukom podložna je subjektivnosti operatora i njegovom nivou poznavanja kako načina ispitivanja tako i svojstava ispitivanog materijala; c) zbog načina ispitivanja i procjene rezultata na mjestu kontrole, osoblike koje rukuje aparatom za ultrazvučnu defektoskopiju mora, osim većeg predznanja, imati dugu praksu uz mogućnost komparativnog utvrđivanja karaktera otkrivene greške; uvođenje ovih metoda je zato mnogo dugotrajnije nego ostalih; d) postoje relativno slabe mogućnosti za otkrivanje potpovršinskih grešaka i grešaka u predmetima komplikiranjih oblika. Poželjno je da su površine upada i odraza zvuka paralelne i glatke.

Zbog navedenih nedostataka, ispitivanje ultrazvukom se često vrši u kombinaciji s metodama prozračavanja na taj način da se mjesta na kojima se ultrazvukom pronašla greška naknadno snime jednom od metoda prozračavanja.

Uredaji i pribor, postupci ispitivanja ultrazvukom. Ultrazvučni defektoskopi proizvode se u tri osnovna oblika. Zavisno od konstrukcije i tipa ispitivanja na zaslonu katodne cijevi pojavljuje se odjek od greške u obliku tzv. A-, B- ili C-slike (engl. A-, B-, C-scan). Uredaji koji prikazuju tzv. A-sliku (slika 20a) najjednostavniji su i najčešće se upotrebljavaju. Odjek od zadnje

stijenke ili od greške pojavljuje se u obliku jednostavnih vertikalnih impulsata. Upotrebljavaju se podjednako za tehniku impuls-jeka ili za transmisionu tehniku ispitivanja. Na B-slici se (sl. 20b), pomoću elektronskih dodataka, u horizontalnoj osi pokazuje dužina ispitnog komada a visina slike u stvari je debljina komada koji se ispituje. Na slici se vidi kolika je greška i koliko je duboko ispod površine. C-slika (sl. 20c), također pomoću dosta složenih elektronskih dodataka, predstavlja površinu na kojoj se predmet ispituje. Putovanje elektronskog snopa ocrtava svaku grešku ispod ispitivane površine u njenoj punoj veličini. Uredaji za slike B i C razvijeni su i uglavnom su u upotrebi u USA, i to pretežno za imerzonu tehniku; u Evropi, uz vrlo malo izuzetaka, proizvode i eksploratori se samo uredaju sa A-slikom.

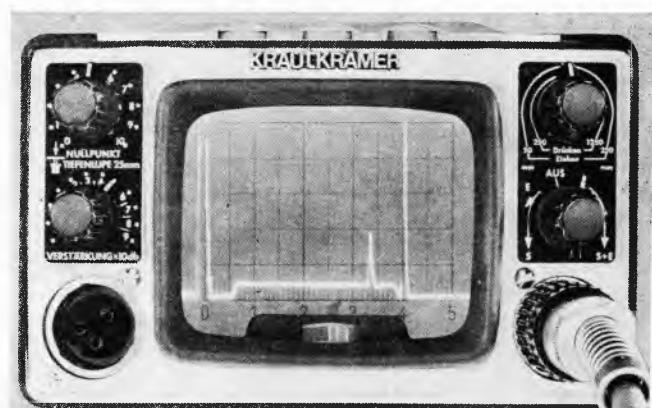
Principijelna shema uredaja za ultrazvučno ispitivanje *metodom impuls-jeka* vidi se na slici 21. Ultrazvučni vibrator (glava) emitira u ispitivani predmet intermitentne impulse određene frekvencije.



Sl. 21. Blok-sHEMA ultrazvučnog aparata za A-sliku i metodu impuls-jeka

Ako se u dubini ispitivanog predmeta ne nalazi greška, ultrazvučni val se, zbog velike razlike u specifičnoj vodljivosti zraka i materijala od kojeg je predmet načinjen, gotovo potpuno reflektira od zadnje površine predmeta i vraća prema prednjoj površini na kojoj se nalazi vibrator. U pauzama između signala vibrator djeluje kao prijemna sonda i primljene impulse šalje u pojačalo, a ovo ih baca na ekran katodne cijevi, te se na njemu pojavljuje »odjek« od zadnje površine u određenoj udaljenosti od prednjog impulsa. Ova udaljenost zavisna je od debljine stijenke ispitivanog predmeta i od brzine širenja zvuka u tom predmetu (tablica 5). Ako se u dubini ispitivanog predmeta nalazi greška, jedan dio impulsa se odbija od njene površine i vraća prije odjeka sa zadnje površine. Greška se očitava na ekranu kao odjek u udaljenosti koja odgovara dubini greške.

Transmisiona tehnika je u principu slična prethodnoj, s tom razlikom da se koristi dvjema odjeljenjima sondama, od kojih jedna samo emitira impulse a druga, smještena na suprotnoj strani ispitivanog predmeta, služi kao prijemnik impulsa nakon prolaza kroz materijal. Ukoliko ultrazvučni impulsi na svom putu nađu na grešku, oni će, u zavisnosti od veličine i karaktera te greške, biti djelomično reflektirani, te će umanjena količina energije proslijediti put do prijemnog vibratora. Greška će se na ekranu katodne cijevi očitovati manjom visinom signala ili, u slučaju veće greške, odsustvom signala.



Sl. 22. Prednja ploča tranzistoriskog ultrazvučnog aparata USK-5M (Krautkrämer, Köln)



Sl. 25. Nekoliko tipova ultrazvučnih vibratora (Krautkrämer, Köln)

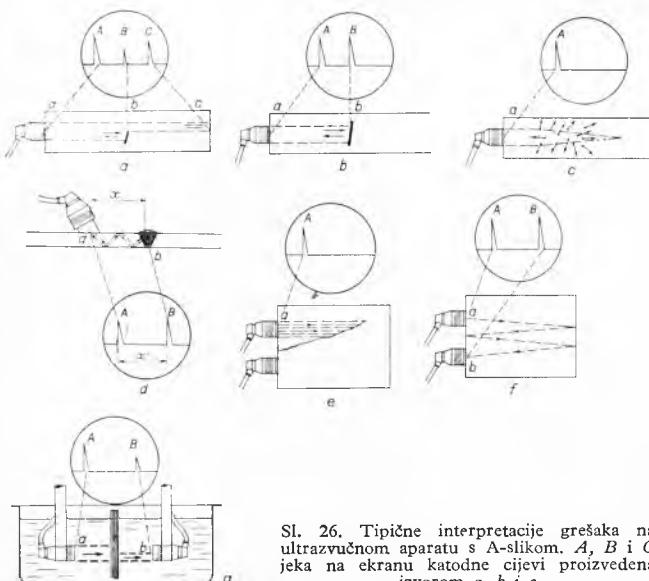
Suvremeni aparati proizvode se za mogućnosti ispitivanja sa obje navedene tehnike. Sl. 24 prikazuje noviji tip tranzistoriziranog ultrazvučnog aparata za ispitivanje transmisionom tehnikom impuls-jeka.

Imerziona tehnika koristi se prvenstveno za kontrolu serijske proizvodnje ili za otkrivanje grešaka neposredno ispod površine ispitivanog predmeta. Ona je u širokoj primjeni u USA. Ispitivan predmet nalazi se u vodenoj kupki kroz koju se upravljaju ultrazvučni impulsi na površinu predmeta. Ova se tehnika koristi principima tehnike impuls-jeka i transmisione tehnike.

Rezonantna tehnika se upotrebljava za defektoskopiju uglavnom samo sekundarno, prilikom njene vrlo omiljene primjene za mjerjenje debljine stijenke. Oscilator pobudivan od vibratora naslonjenog na stijenknu modulira (ugada) se na pogodan način dok njegova frekvencija ne postigne vrijednost pri kojoj se u stijenki obrazuje stojni val; u tom trenutku mijenja se impedanca vibratora i to se na ekranu osciloskopa očituje kao karakterističan impuls. Elementi ugadanja zavise od debljine stijenke i ova se u modernim aparatima na dodatnom uredaju neposredno očitava. Ako u stijenki ima greška, to se očituje kao smetnu ugadanju.

Kao *emiter* ultrazvuka najčešće se upotrebljava piezoelektrična pločica pogodno smještena u držać koji u sebi sadrži kontakte za spoj s aparaturom, a često i foliju koja štiti piezo-pločicu od habanja. Piezo-pločice upotrebljive za defektoskopiju izrađene su od kvarca, Seignetteove soli, barijum-titanata, turmalina i dr. Frekvencija kojom će vibrator rezonirati zavisna je od debljine i osi presjeka kristala, a širina snopa zvuka od ostalih dimenzija pločice. Izgled nekoliko izvedenih vibratora za longitudinalne, transverzalne i površinske valove prikazan je na slici 25.

Interpretacija rezultata ultrazvučnih mjerjenja. Zbog načina na koji je (osim na C-slici) greška prikazana na ekranu



Sl. 26. Tipične interpretacije grešaka na ultrazvučnom aparu s A-slikom. A, B i C jeka na ekranu katodne cijevi proizvedena izvorom a, b i c

katodne cijevi, a i zbog mnogo drugih subjektivnih elemenata, interpretacija rezultata ispitivanja vrlo je zavisna od spretnosti, znanja i uvježbanosti ispitivača. Sl. 26 pokazuje nekoliko tipičnih interpretacija grešaka. Ultrazvučni val djelomično odbijen sa površine greške pokazuje se kao udaljenost između početnog impulsa i jeke sa stražnje površine (sl. 26 a). Ako je greška veća od emitiranog snopa zvuka, ne pojavljuje se odjek sa stražnje površine (sl. 26 b). Ako ima porozitetu u materijalu, zvučni snop se odbija u svim smjerovima i nema odjeka (sl. 26 c). Sučeno zavareni spojevi najčešće se ispituju kutnim vibrаторom sa transverzalnim valovima (sl. 26 d). Slike 26 e i f pokazuju moguće načine ispitivanja upotrebom vibradora s odijeljenim emiterom i prijemnikom i novijih vibradora u kojima su emiter i prijemnik konstruktivno spojeni u jednoj sondi (tzv. SE-vibrator, prema njem. Sende-Echo). Sl. 26 g prikazuje princip ispitivanja u imerzionoj tehnici.

MAGNETSKE I ELEKTROMAGNETSKE (INDUKTIVNE) METODE

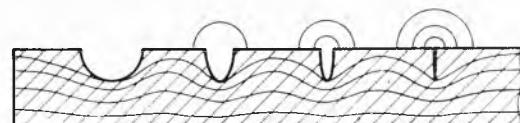
Fizičke osnove i principi magnetskih i induktivnih ispitivanja. Defektoskopija magnetskim i induktivnim metodama bazira se na nekoliko osnovnih svojstava materijala ili magnetskog polja, a to su električna provodljivost, permeabilitet i koercitivna sila. Te metode ustanavljanja grešaka u materijalu dijele se u dvije osnovne grupe: metode koje se koriste poslijedicama djelovanja magnetskih silnica proizvedenih u namagnetiziranom ispitivanom predmetu i metode koje se koriste induktivnim djelovanjem izmjeničnog magnetskog polja. Prvom se grupom metoda mogu ispitivati samo feromagnetski materijali, drugom se osim feromagnetskih mogu ispitivati i neferomagnetski materijali.

Prolazom električne struje kroz neki vodič stvara se oko njega koncentrično magnetsko polje jakosti zavisne od jačine struje u vodiču. Magnetske silnice (magnetski fluks) prolazeći kroz određeni presjek magnetskog vodiča tvore gustinu polja

$$B = \mu H,$$

gdje je μ permeabilitet a H jačina magnetskog polja. Sposobnost vodenja magnetskih linija — permeabilitet — različitih materijala vrlo je različit. Ako se permeabilitet vakuuma postavi $\mu_{rel} = 1$, onda se nazivaju materijali sa $\mu_{rel} < 1$ dijamagnetskim, sa $\mu_{rel} \approx 1$ paramagnetskim, a $\mu_{rel} > 1$ feromagnetskim. Relativni permeabilitet željeza je ~ 100 puta veći od permeabilite paramagnetskih medija. U zavisnosti od sastava i termičke obrade čelika mijenja se μ_{rel} čelika u dosta širokim granicama.

Ako u materijalu postoji diskontinuitet (u obliku greške ili nekom drugom obliku) dolazi do ugiba magnetskih silnica, do



Sl. 27. Utjecaj površinski vezanog zareza (pukotine) na stvaranje rasipnog magnetskog polja

njihove koncentracije i do povećanja jakosti polja u različnom rasponu (sl. 27). Ova pojava predstavlja osnovu magnetskih ispitivanja feromagnetskih materijala.

Ako se neki vodič nalazi u izmjeničnom magnetskom polju koje stvara zavojnica, u njemu se inducira izmjenična struja, koja opet stvara svoje polje. Mjerenje novonastalog izmjeničnog polja, zavisnog od diskontinuiteta u materijalu vodiča, predstavlja osnovu induktivnih metoda defektoskopije.

Područje upotrebe induktivnih i magnetskih metoda. Mala investicija i vrlo jeftino ispitivanje uz jednostavniju tehniku popularizirale su magnetske metode ispitivanja materijala. U najnovije vrijeme konstruirani su i vrlo složeni elektronički potpuno automatizirani uredaji (proizvodi ih Institut Dr. Förster, Magnaflux Corporation) za kontrolu i sortiranje produkata masovne proizvodnje (crne metalurgije, automobiličke i vojne industrije itd.).

Osnovne prednosti ovih metoda su ove: a) jednostavnost principa i niska cijena uredaja (osim automatiziranih); b) lako i jednostavno rukovanje uredajima; c) dobra osjetljivost na otkri-

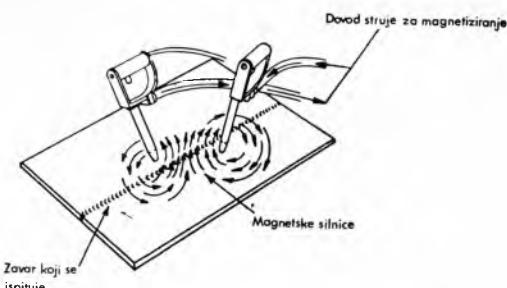
vanje površinskih i potpovršinskih grešaka, posebno pukotina (to je prednost naročito u odnosu na metode ultrazvuka); d) interpretacija rezultata ne zahtijeva naročitu stručnost; e) mogućnost primjene na proizvode složenih oblika i s velikim razlikama u debljinama stijenke (to su očite prednosti pred metodama prozračavanja i prozvučavanja).

Ograničenja upotrebe i nedostaci induktivnih i magnetskih metoda jesu ovi: a) ustanovljava se postojanje grešaka, a ne i njihova geometrija (ako se ne upotrijebi posebni dodatni uređaji); b) dubinske greške se, osim magnetografskom metodom, teško otkrivaju i identificiraju; dubina pouzdano otkrivanja iznosi tek nekoliko milimetara, a najpozdanije se otkrivaju greške koje imaju vezu sa površinom; c) osim s uredajima za kontrolu masovne proizvodnje, ove su metode prilično spore; d) interpretacija rezultata dosta zavisi od stanja površine ispitivanog predmeta.

Zbog navedenih nedostataka metode sa magnetnim prahom upotrebljavaju se za komplikirane oblike feromagnetskih proizvoda, a ostale se metode (induktivne, metode vrtložnih struja, strujne provodljivosti) primjenjuju za kontrolu jednostavnijih oblika veće duljine (cijevi, šipaka, profila, žica i sl.).

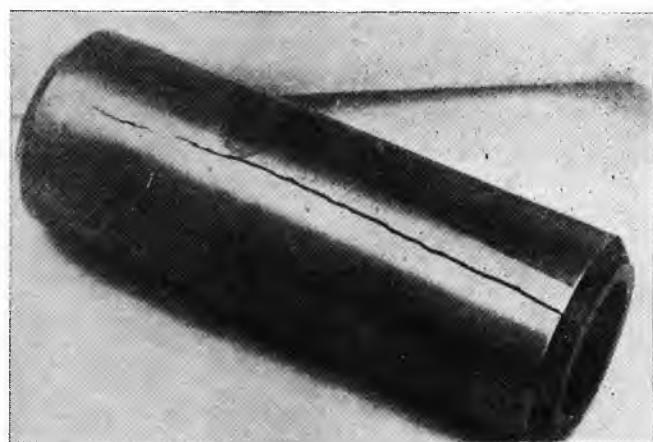
Magnetske metode se danas često upotrebljavaju i uporedno s drugim defektoskopskim metodama. Danas su još uvijek u stadiju brzog razvoja.

Uredaji, pribor i postupci magnetskih i induktivnih ispitivanja. Najjednostavnije uredaje za magnetska ispitivanja



Sl. 28. Princip djelovanja ferofluks-aparata

predstavljaju *feroflux-aparati*. To su generatori istosmjernih ili izmjeničnih struja velike jakosti a niskog napona. Izrađuju se u prenosnoj i stabilnoj izvedbi. Princip rada jednog prenosnog uređaja vidi se na sl. 28. Krajevi sekundarnog namotaja transformatora u obliku tzv. *pipala* kratko se spoje preko površine feromagnetskog predmeta koji se ispituje. Na nastalo magnetsko polje sipa se magnetit ($\text{Željezo-oksid } \text{Fe}_3\text{O}_4$) u obliku finog praška, veličine zrna $\sim 1\text{ }\mu\text{m}$ ili prašak suspendiran u lakom mineralnom ulju i sl. Zbog



Sl. 30. Pukotina otkrivena metodom magnetskog praška

opisane pojave dolazi do koncentracije praška na mjestima površinskih ili potpovršinskih grešaka. Promatranje se vrši na dnevnom ili (kod posebnih praškova) ultraljubičastom svjetlu. Treba napomenuti da je otkrivanje grešaka najbolje ako su one okrenute poprijeko na smjer silnica. Zato treba redovito predmet magnetizirati u dva smjera.

Uredaji za masovnu kontrolu na principu magnetskog praha obično su snabdjeveni kupkama sa suhim prahom suspendiranim u zračnom jastuku, u koje se uranjuju namagnetizirani ispitni predmeti.

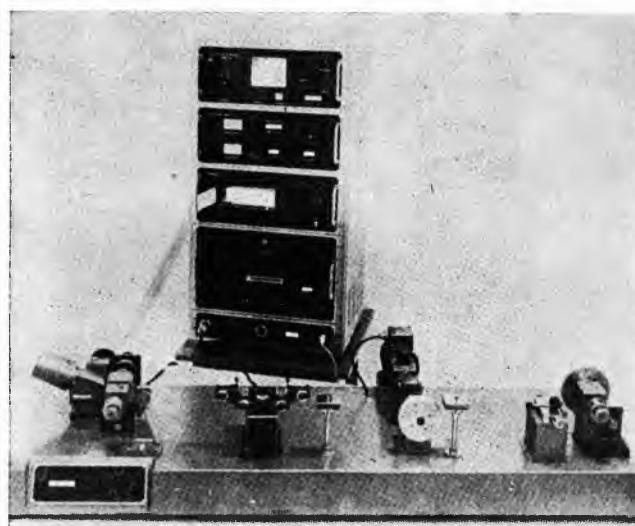
Razvijenje metode, uglavnom za serijsku kontrolu pravilnih i jednostavnih oblika, jesu *magnetografske metode*. U magnetografskim uredajima beskonačna gumena ili plastična traka, na kojoj je jednoliko nanesen magnetski pigment te ona ima tačno određena magnetska svojstva, priljubljuje se čvrsto na površinu magnetiziranog ispitnog predmeta. Kao posljedica remanentnog magnetizma ostaju na traci zabilježene sve nepravilnosti magnetskog polja na ispitnom predmetu, koje su posljedica grešaka. Posebnim sistemom rotirajućih sondi ovako snimljena traka »čita« se i registruje preko elektroničkih uredaja. U današnjem stupnju razvoja magnetografskih metoda njima se mogu otkrivati greške u materijalu do dubine 28 mm.

Uredaji za defektoskopiju metodama mjerjenja magnetskog polja, vrtložnih struja i strujne vodljivosti vrlo su složeni mehanički i elektronički aparati. Primjena im, zbog složenosti i skupoće, nije prešla okvire istraživačkih laboratorija ili velikih industrija masovne proizvodnje. Sl. 29 prikazuje jedan kompletan uredaj za defektoskopiju tanke žice s elektronikom i pisačem za statističku kontrolu.

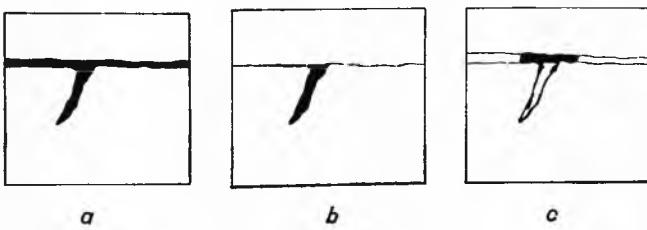
Interpretacija rezultata dobivenih metodama s magnetskim praškom jednostavna je. Na sl. 30 prikazan je izgled pukotine na cilindričnom zatiku, dobiven upotrebom »mokre metode«. Interpretacija rezultata dobivenih automatiziranim metodama gotovo redovito je vezana s označavanjem grešaka na površini, sortiranjem po kvalitetu i izlučivanjem škarta.

PENETRANTSKE METODE DEFEKTOŠKOPIJE

Penetrantske metode defektoskopije (metode *kapilarne defektoskopije*) osnivaju se na činjenici da se tekućine velike površinske aktivnosti (kapilarne aktivnosti), zvane u ovom slučaju *penetrantima*, uvlače u vrlo uske, oku nevidljive pukotine na površini materijala i šupljine koje su u vezi s površinom, te se — pošto se ukloni višak tekućine s površine — mogu učiniti vidljivima na dnevnom ili ultraljubičastom svjetlu. Tome služi tzv. *razvijač*, prah ili suspenzija vrlo finog razdjeljenja koji nanijet na površinu materijala, kapilarnim djelovanjem izvlači površinski aktivnu tekućinu na vidjelo iz pukotine i šupljina. Za svoj nagli razvoj u posljednjih petnaestak godina te metode zahvaljuju naporima da se pronađu jednostavni i efikasni načini otkrivanja površinskih grešaka ili potpovršinskih grešaka koje imaju vezu s površinom u nemagnetičnim materijalima i u nemetalima, posebno plastičnim masama. Zbog svoje jednostavnosti one su se, međutim, jako raširile kako za magnetične tako i za nemagnetične materijale u mnogim granama industrije i eksploracije.



Sl. 29. Uredaj za automatsko ispitivanje tanke žice pomoću vrtložnih struja (Institut dr. Förster, Reutlingen). U prednjem planu uredaj za kontinuirani prolaz žice kroz specijalne sonde. U pozadini elektronički registratori koji bilježi svaku otkrivenu grešku, registrira defektne dužine i daje statističke podatke o upotrebljivosti ispitane žice



Sl. 31. Princip ispitivanja pomoću penetrantata

Princip ispitivanja penetrantima prikazan je na sl. 31.

Ispitivana površina prekrije se penetrantskom tekućinom urednjavanjem, štrcanjem ili nanošenjem kistom (a). Nakon perioda penetracije (koji, zavisno od tipa penetranta, od temperature i od površine i materijala koji se ispituje, iznosi 2–30 minuta), dobro se obriše ili opere i osuši površina ispitivanog predmeta (b), pa se onda na nju nanese (suhi ili mokri) razvijač. Penetrant koji je zaostao u pukotinama i šupljinama ulazi uslijed kapilarnosti u razvijač (c) i — budući da sadrži boju ili fluorescentnu tvar — pokazuje na vidljivom ili ultraljubičastom svjetlu gdje se nalaze dotad nevidljive nehomogenosti površine.

Materijali i pribor za penetrantsku defektoskopiju. Materijali za penetrantsku defektoskopiju, prema naprijed rečenom, obuhvaćaju tri grupe tvari: penetrante, tekućine za spiranje penetranta s površine i razvijače.

Penetranti se sastoje od osnovne površinske aktivne tekućine ili smjese tekućina (petroleja, toluola, tributilfosfata, sulfoniranog ricinusovog ulja, mineralnog ulja i dr.), kojoj su dodate — već prema tipu penetranta — boje ili fluorescentne tvari i dodaci koji omogućavaju uklanjanje viška penetranta s površine ispitanih materijala. Brojni tipovi penetrantskih tekućina koje se danas u svijetu upotrebljavaju mogu se podijeliti sa nekoliko gledišta. Prema tome da li greške postaju vidljive na danjem ili ultraljubičastom svjetlu, postoje dvije vrste penetrantata sa mnogo gradacija u svakoj od njih. Uzme li se k tome u obzir i način kako se tekućina spire s ispitane površine, dobiva se podjela navedena u nastavku.

Vodoisperivi penetranti za dnevno svjetlo sadrže uz boje (po pravilu fluorescentne) neki detergent i/ili u voditoplivo otapalo penetrantske tvari, koji omogućuju da se višak penetranta emulgira u vodi i ukloni s površine naprsto vodenim mlazom. Zbog toga i jer nije potrebno ultraljubičasto svjetlo, rad s takvim penetrantima je vrlo jednostavan, pa se stoga oni mnogo upotrebljavaju. Osjetljivost im je srednje dobra ako su ispitivane površine brižljivo pripremljene.

Vodoisperivi penetranti za ultraljubičasto svjetlo, zbog jače fluorescencije u tom svjetlu, osjetljiviji su od prethodnih. Upotrebljavaju se prvenstveno za kontrolu grubljih površina, zupčanika, navoja i sl. Ispitivanje s njima je brzo i ekonomično; nepodesni su za kromirane površine. Promatranje se mora vršiti u tamnoj prostoriji pod kvarc-lampom.

Penetranti za rad s naknadnim emulgiranjem nemaju dodatka koji omogućava njihovo emulgiranje i neposredno ispiranje vodom. Oni se uklanjuju s površine na taj način da se na sloj penetranta, prije ispiranja vodom, nanese sloj tekućine koja sadrži emulgator. Budući da voda pri ispiranju ne može uklanjati i jedan dio penetranta iz pukotina i šupljina — a što se ne može sprječiti pri direktnom spiranju vodoisperivih penetrantata — metoda s naknadnim emulgiranjem, uz promatranje u ultraljubičastom svjetlu, predstavlja najosjetljiviju metodu za otkrivanje najfinijih grešaka. Može se upotrijebiti i za kontrolu galvaniziranih i kromiranih površina. Ta brza i ekonomična metoda u širokoj je primjeni u USA i gotovo je jedina koja se upotrebljava u velikim stacionarnim uredajima za masovnu kontrolu. U Evropi se zasad dosta rijetko nalazi.

Kao razvijač upotrebljava se najčešće kreda, ali također talk, bentonit, koloidna kremena kiselina, diatometska zemlja, bilo kao suhe smjese ili kao suspenzije u lako isparljivoj tekućini (većinom etilalkoholu ili izopropilalkoholu), kojoj je gotovo uvijek dodata neka tvar koja sprečava koroziju.

Primjena penetrantskih metoda defektoskopije. Već je naglašeno da je upotrebljivost penetrantskih metoda ograničena na otkrivanje grešaka koje imaju vezu s ispitivom površinom. Osim toga ograničenja postoji još i to da površine koje se tim metodama ispituju moraju biti razmjerno glatke i čiste (ne smiju biti ličene). Treba izbjegavati i ispitivanje površina vrlo osjetljivih



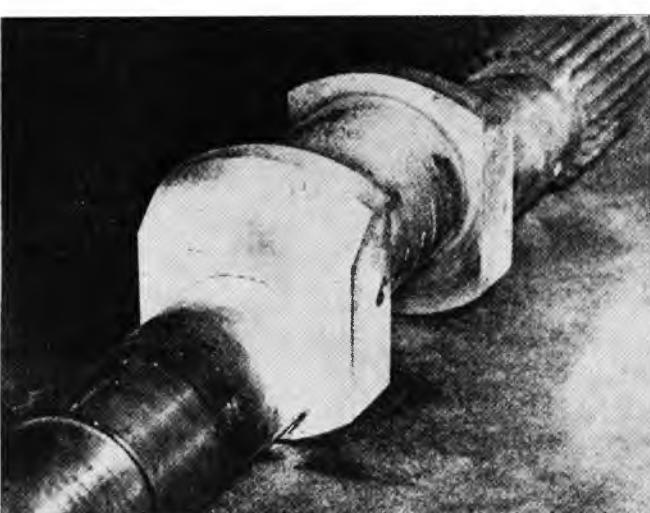
Sl. 33. Prenosni komplet za ispitivanje penetrantata (Magnaflux Corporation)

prema koroziji. Brzina ispitivanja tim metodama i njihova efikasnost zavisi također od temperature površine i okoline. Interpretacija rezultata dobivenih penetrantskom defektoskopijom vrlo je jednostavna. Uopće je jednostavnost i niska cijena kontrole uz upotrebu penetrantata osnovna prednost tih metoda. Sl. 32 pokazuje, primjera radi, pukotinu na koljenčastom vratilu otkrivenu penetrantskom metodom defektoskopije.

Uredaji za defektoskopiju penetrantima proizvode se u obliku prenosnih kompleta (sl. 33) ili kao stacionarna postrojenja kojima je rad uglavnom automatiziran, osim pregleda i interpretacije.

LIT.: E. A. W. Müller, Materialprüfung nach dem Magnetpulver-Verfahren, Leipzig 1951. — E. Hanke, Prüfung metallischer Werkstoffe II, Leipzig 1960. — D. Frost, Praktischer Strahlenschutz, Berlin 1960. — E. A. W. Müller, Handbuch der zerstörungsfreien Materialprüfung, München 1963. — R. C. McMaster, Nondestructive testing handbook, New York 1963. — Неразрушающие испытания (справочник), Москва 1965. — J. Krautkrämer, H. Krautkrämer, Werkstoffprüfung mit Ultraschall, Berlin-Heidelberg-New York 1966. — Za magnetografske metode i metode vrtložnih struja: F. Förster, Förster Report No 7, 8, 9, 1967. — Časopisi: Materials Evaluation, USA, Дефектоскопия, СССР, The British Journal of Nondestructive Testing, V. Britanija, Zerstörungsfreie Materialprüfung, SR Njemačka.

K. Ljubić



Sl. 32. Pukotina otkrivena ispitivanjem pomoću penetrantata